PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-299764

(43)Date of publication of application: 24.10.2000

(51)Int.CI.

H04N 1/04

HO4N 1/028 HO4N 1/409

(21)Application number: 11-105497

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

13.04.1999

(72)Inventor: KOZUKA HIRAKI

(54) IMAGE SENSOR UNIT AND IMAGE READER USING THE SENSOR UNIT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an inexpensive image sensor unit which can increase the image reading speed without lowering the output level of a photoelectric transform signal by starting the driving of a light irradiation means of the unit together with a photoelectric transducer and ending the driving of the light irradiation means when the photoelectric transform signal is inputted from the photoelectric transducer.

SOLUTION: The optical carriers which are generated by the photoelectric transform of the photodiodes PDa-PDd of photodetectors a1-ad undergo the electric charge/voltage transform via the MOS source followers M3a-M3d and are transferred to the storage capacitros Ca-Cd by a signal transfer pulse ϕT with coincidence of all pixels. Then the

read switches M1a-M1d are sequentially turned on by the read pusels ϕa1-ϕd1 which are sent from a shift register 11 and sequentially set at high levels, and the signal voltage is read out on a common signal line 14 as the division of capacity. In a high resolution mode, the pulses ϕa1-ϕd1 are sequentially turned on and the adjacent pulses ϕa1 and ϕb1 are simultaneously turned on in a low resolution mode.

ϕb1 are simultaneously turned on in a low resolution mode. Then the pulses ϕc1 and ϕd1 are simultaneously turned on.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] When the photo-electric-translation signal which said Mitsuteru gunner stage starts actuation with said photoelectrical inverter in the image-sensors unit which equips a manuscript with the photoelectrical inverter which has the Mitsuteru gunner stage which irradiates light, and two or more photo-electric-translation means which carry out incidence of the light from said manuscript, and is outputted from said photoelectrical inverter is inputted, it is the image-sensors unit characterized by ending said actuation. [Claim 2] Said Mitsuteru gunner stage is an image-sensors unit according to claim 1 characterized by being LED.

[Claim 3] Said photoelectrical inverter is the image-sensors unit according to claim 1 characterized by to have the resolution switch means which switches the 1st resolution and the 2nd resolution changed by said photo-electric-translation means, the resolution control means which controls a switch of the resolution in said resolution switch means, and a magnification means amplify the photo-electric-translation signal outputted from said photo-electric-translation means according to the amplification factor controlled by said resolution control means.

[Claim 4] A noise signal maintenance means by which said photoelectrical inverter reads and holds a noise signal from said photo-electric-translation means, A lightwave signal maintenance means to read and hold a lightwave signal from said photo-electric-translation means, The 1st read-out means which reads two or more noise signals outputted from said noise signal maintenance means to a noise signal common output line, With the 2nd read-out means which reads two or more lightwave signals outputted from said lightwave signal maintenance means to a lightwave signal common output line, and said 1st read-out means and the 2nd read-out means The resolution switch means which switches the resolution of the picture signal changed by said photo-electric-translation means, The resolution control means which controls a switch of the resolution in said resolution switch means, the difference which takes the difference of said noise signal and said lightwave signal -- a means and said difference -- the image-sensors unit according to claim 1 characterized by having a magnification means to amplify the photo-electric-translation signal outputted from the means according to the amplification factor controlled by said resolution control means.

[Claim 5] The image-sensors unit according to claim 3 characterized by being G2>G1 when said amplification factor at the time of said 1st resolution is set to G1 and said amplification factor at the time of said 2nd resolution is set to G2.

[Claim 6] Said noise signal maintenance means is equipped with the capacity of capacity value CTN, and said lightwave signal maintenance means is equipped with the capacity of capacity value CTS. And are CTS**CTN**CT and said noise signal common output line is equipped with the parasitic capacitance of capacity value CHN. Said lightwave signal common output line is G2-/G1=(NxCT+CH)/(CT+CH), when it had the parasitic capacitance of capacity value CHS, and it is CHN**CHS**CH, said amplification factor at the time of said 1st resolution is further set to G1 and said amplification factor at the time of said 2nd resolution is set to G2.

The image-sensors unit according to claim 5 which comes out and is characterized by a certain thing. [Claim 7] The image-sensors unit which equips a manuscript with the photoelectrical inverter which has the Mitsuteru gunner stage which irradiates light, and two or more photo-electric-translation means which carry out incidence of the light from said manuscript, In the image reader equipped with the sensor driving means which drives said image sensors said image-sensors unit It is the image reader which starts actuation with the actuation start signal outputted from said driving means, and will be characterized by ending said actuation if said Mitsuteru gunner stage inputs the photo-electric-translation signal outputted from said photoelectrical inverter.

[Claim, 8] Said Mitsuteru gunner stage is an image reader according to claim 7 characterized by being LED. [Claim 9] Said photoelectrical inverter is the image reader according to claim 7 characterized by to have the resolution switch means which switches the 1st resolution and the 2nd resolution changed by said photoelectric-translation means, the resolution control means which controls a switch of the resolution in said resolution switch means, and a magnification means amplify the photo-electric-translation signal outputted from said photo-electric-translation means according to the amplification factor controlled by said resolution control means.

[Claim 10] A noise signal maintenance means by which said photoelectrical inverter reads and holds a noise signal from said photo-electric-translation means, A lightwave signal maintenance means to read and hold a lightwave signal from said photo-electric-translation means, The 1st read-out means which reads two or more noise signals outputted from said noise signal maintenance means to a noise signal common output line, With the 2nd read-out means which reads two or more lightwave signals outputted from said lightwave signal maintenance means to a lightwave signal common output line, and said 1st read-out means and the 2nd read-out means The resolution switch means which switches the resolution of the picture signal changed by said photo-electric-translation means, The resolution control means which controls a switch of the resolution in said resolution switch means, the difference which takes the difference of said noise signal and said lightwave signal -- a means and said difference -- the image reader according to claim 7 characterized by having a magnification means to amplify the photo-electric-translation signal outputted from the means according to the amplification factor controlled by said resolution control means.

[Claim 11] The image reader according to claim 9 characterized by being G2>G1 when said amplification factor at the time of said 1st resolution is set to G1 and said amplification factor at the time of said 2nd resolution is set to G2.

[Claim 12] Said noise signal maintenance means is equipped with the capacity of capacity value CTN, and said lightwave signal maintenance means is equipped with the capacity of capacity value CTS. And are CTS**CTN**CT and said noise signal common output line is equipped with the parasitic capacitance of capacity value CHN. Said lightwave signal common output line is G2-/G1=(NxCT+CH)/(CT+CH), when it had the parasitic capacitance of capacity value CHS, and it is CHN**CHS**CH, said amplification factor at the time of said 1st resolution is further set to G1 and said amplification factor at the time of said 2nd resolution is set to G2.

The image reader according to claim 11 which comes out and is characterized by a certain thing.

[Translation done.]

* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention] [0001]

[Field of the Invention] This invention is concerned with burning period control of the light source of the photoelectrical inverter which has especially a resolution switch function, an image-sensors unit including the light source, and an image reader about the image-sensors unit used for image readers, such as facsimile, an image scanner, and a digital process copying machine, and it.

[0002]

[Description of the Prior Art] In recent years, in the field of a photoelectrical inverter, the photoelectrical inverter (for example, JP,1-154678,A) of BASIS which prepared the bipolar transistor in each pixel other than CCD as an amplifier, and the magnification mold which prepared the MOS transistor in each pixel as an amplifier etc. is proposed. In the photoelectrical inverter of such a magnification mold, there is a problem that the variation of an amplifier prepared in each pixel serves as a fixed pattern noise (FPN is called below Fixed Pattern Noise:.), and various proposals are made about the FPN clearance approach.

[0003] (Conventional technique 1) As one of the FPN clearance approaches, the approach of amending the variation in an amplifier is proposed by taking the difference of a lightwave signal (S signal) and the signal (N signal) of a dark condition. This FPN amendment technique is shown in <u>drawing 11</u> and <u>drawing 1212</u>. [0004] The circuit diagram for 1 bit of the 1-dimensional photoelectrical inverter with which <u>drawing 11</u> has a photoelectrical inverter in each pixel, and <u>drawing 12</u> are the timing chart (television institute magazine Vol.47, No9(1993) pp.1180).

[0005] The circuit actuation shown in <u>drawing 11</u> and FPN clearance are explained. First, the lightwave signal retention volume CTS 101 and the noise signal retention volume CTN102 are reset, and then the charge according to the quantity of light is received at the base to the bipolar transistor 109 which is a sensor. And after are recording of the charge which received light is completed, the lightwave signal containing a noise is transmitted to the lightwave signal retention volume CTS 101.

[0006] It continues, the reset action of a bipolar transistor 109 is performed, and a noise signal is transmitted to the noise signal retention volume CTN102. And again, the reset action of a sensor is performed and are recording actuation requires. Moreover, a shift register starts a scan during are recording actuation.
[0007] First, after using the lightwave signal common output line 103 and the noise signal common output line 104 and resetting reset 105 and MOSs 106 first, the data of the lightwave signal retention volume CTS 101 and the noise signal retention volume CTN102 are outputted to the common output lines 103 and 104 at the capacitive component rate with the common output line capacity CHS 107 and the common output line

capacity CHN108, respectively.

[0008] Here, although the common output line capacity CHS107 and CHN108 is the capacity of each common output line, CHS and a noise signal common output line are henceforth defined for a lightwave signal common output line as CHN. Then, again, the common output line capacity CHS 107 and the common output line capacity CHN108 are reset, and the data of the lightwave signal retention volume CTS of the following pixel which is not illustrated and the noise signal retention volume CTN are read. [0009] This actuation is repeated and the signal of all pixels is outputted. The outputted signal is inputted into the differential amplifier 115 through voltage HOROA 113 and 114, respectively, and serves as an output of a photoelectrical inverter. Here, it becomes as for FPN in a chip, what mainly originates in variations, such as hFE of the bipolar transistor 109 of each pixel, is main, and possible to remove FPN resulting from the hFE variation for every pixel with the above-mentioned S-N method. [0010] In addition, FPN here is a fixed pattern noise at the time of dark, and FPN defines it as the fixed

[0010] In addition, FPN here is a fixed pattern noise at the time of dark, and FPN defines it as the fixed pattern noise at the time of dark henceforth.

[0011] Below, the FPN clearance in the conventional technique is explained.

[0012] In <u>drawing 11</u>, the signal (Sout) of the lightwave signal common output line 103 and the signal (Nout) of the noise signal common output line 104 are expressed with a degree type.

Sout=(VSxCTS)+(VCHSxCHS)/(CTS+CHS)

Nout=(VNxCTN)+(VCHRxCHN)/(CTN+CHN)

here -- VN:noise signal reading appearance -- carrying out -- the electrical potential difference of the noise signal storage capacitance CTS at the time, and VS:lightwave signal reading appearance -- carrying out -- the electrical potential difference of the lightwave signal storage capacitance CTS at the time -- it comes out. That is, it will become VS=VSIG+VN if the electrical potential difference of a lightwave signal component is set to VSIG.

[0014] It sets at (1) and (2) ceremony and is CHS=CHN=CHVS=VN=VCT (at the time of dark).

If it is CTS=CTN=CT, the above-mentioned differential signal will be set to Sout-Nout=0.

[0015] Moreover, since VS serves as VS=VSIG+VN a carrier beam case in the predetermined quantity of light, it can read only a true lightwave signal text from VSIG=VSIG+VN-VN. Therefore, even if VCT varies for every pixel, since the differential signal of (1) and (2) types is set to 0, it supposes that FPN can be removed.

[0016] (Conventional technique 2) Although the above-mentioned conventional technique 1 is the example which used the bipolar transistor as a photo detector, the photoelectrical inverter which used photo diode and MOS amplifier is proposed by JP,9-205588,A instead of the bipolar transistor.

[0017] In this official report, it is indicated that FPN resulting from the threshold variation of an MOS source follower established for every pixel can be reduced using the FPN clearance circuit of the conventional technique 1.

[0018] (Conventional technique 3) For example, the image formation equipment, the control approach, and system which used the image sensors of a light source switch mold are proposed by JP,10-126575,A.

[0019] Drawing 13 is drawing showing the image formation equipment carried by the above-mentioned official report. This image formation equipment irradiates the light of different wavelength from two or more LED light sources 113,114,115 first. When the reading sensor 112 reads the irradiated image, the flash mode setting register 706 switches the 1st mode in which an image is read in a single color, and the 2nd mode read in two or more colors. Moreover, the burning time amount of the light source 113,114,115 is set up by the burning time-control register 702, the burning time amount counter 703, and the burning time amount regulating circuit 705, and the current supplied to the light source 113,114,115 is set up by the lighting current control circuit 707. And CPU performs these control according to the mode.

[0020] (Conventional technique 4) Further, about the photoelectrical inverter of a resolution switch method, in JP,5-227362,A, the control terminal for resolution control is prepared newly, and adhesion mold image sensors with a user able to switch resolution in accordance with utilization conditions are proposed, for example. <u>Drawing 14</u> is the circuit diagram of the integrated circuit for contact type image sensors proposed by the open official report concerned.

[0021] In this conventional technique, the control terminal (125) was prepared in the image-sensors chip, and when a user inputs the signal of high level or a low level into that terminal, the resolution switch is realized. If an approximate account is carried out about <u>drawing 14</u>, if a shift register 104 is started by a start pulse SI and the clock pulse CLK, the output will be inputted into the channel select switch 103 through NOR gate 121 and AND gate 120, will turn this ON, and will take out the signal from a photo cell 101 to a signal line 107 by them.

[0022] Here, analog switch 110a etc. is switched by "H" or "L" of the signal inputted into the control signal input terminal 125, and a picture signal is acquired at the image output terminal 111 by 16-dot [/mm] or 8 dot [/mm] the consistency of reading. That is, although total is always operating, in case the photo cells 101a-101l. on Sensor IC take out an output picture signal outside, they are taken as the ability of a part to be made to thin out and output with a control signal. [0023]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the resolution switch method of the contact type image sensor currently indicated by the above-mentioned conventional technique 4, resolution is switched by skipping a pixel. Therefore, when resolution is usual, or when resolution is made into one half and both clock rates are the same, read-out time amount does not change.

[0024] Supposing a photo detector is arranged in the optical resolution of 600dpi and the resolution of 300dpi is obtained in 600dpi and low resolution mode in high resolution mode, when the reading rate of 6

msec/line is obtained at the time of 600dpi, it will read, even if it becomes the reading rate of 6 msec/line and drops resolution also on the time of 300dpi, and a rate will not change, for example. That is, it reads and there is a problem according to resolution that a rate is unrealizable.

[0025] Here, a reading rate is mostly equivalent to the storage time of capacity. Therefore, the storage time at the time of 300dpi serves as the abbreviation half of the storage time at the time of 600dpi. Therefore, there are also few amounts of charges accumulated in capacity. Therefore, in order to obtain the strength of the same optical output as the case of high resolution in the case of a low resolution, it is necessary to make it into twice read-out gain.

[0026] However, for example, in the pixel addition by the capacitive component rate, when performing 2-pixel division addition, the ratio of read-out gain is set to {2CT/(2 CT+CH)}/{CT/(CT+CH)} = (CT+CH)/(C<SUB>T+CH/2) <2. That is, read-out gain becomes less than two.

[0027] in order to obtain the same signal output by capacitive component rate addition for N pixel at the time of a resolution switch since the storage time serves as 1-/N in switching resolution to 1-/N if the above-mentioned example is generalized -- N twice, although reading appearance is carried out and gain is needed reading appearance -- carrying out -- the ratio of gain -- {NCT/(NCT+CH)}/{CT/(CT+CH)} = (CT+CH)/(CT+CH/N)<N -- becoming -- N twice -- reading appearance cannot be carried out and gain cannot be acquired.

[0028] Moreover, although the conventional technique 3 is the control system of an image-sensors unit without resolution switch mode, when controlling each parameter in all the modes of operation that include the time of a resolution switch in this control system, a system may become complicated and it may become the high thing of cost.

[0029] That is, in the conventional technique, the image reader which can obtain equivalent optical output signal level cheaply at the time of a resolution switch may be unable to be offered.

[0030] Then, this invention makes it a technical problem to offer the using [prevent lowering of the output level of a photo-electric-translation signal and] cheap image-sensors unit and cheap it [even if it reads, and it realizes a rate and it speeds up / reading] image [resolution] reader according to resolution at the time of a switch.

[0031]

[Means for Solving the Problem] In order to solve the above-mentioned technical problem, in the image-sensors unit with which this invention equips a manuscript with the photoelectrical inverter which has the Mitsuteru gunner stage which irradiates light, and two or more photo-electric-translation means which carry out incidence of the light from said manuscript, said Mitsuteru gunner stage starts actuation with said photoelectrical inverter, and if the photo-electric-translation signal outputted from said photoelectrical inverter is inputted, it will end said actuation.

[0032] Moreover, the image-sensors unit with which this invention equips a manuscript with the photoelectrical inverter which has the Mitsuteru gunner stage which irradiates light, and two or more photoelectric-translation means which carry out incidence of the light from said manuscript, In the image reader equipped with the sensor driving means which drives said image sensors said image-sensors unit Actuation is started with the actuation start signal outputted from said driving means, and said Mitsuteru gunner stage will end said actuation, if the photo-electric-translation signal outputted from said photoelectrical inverter is inputted.

[0033]

[Embodiment of the Invention] Hereafter, the operation gestalt of this invention is explained using a drawing.

[0034] [Operation gestalt 1] <u>drawing 1</u> is the circuit block diagram of a contact type image sensor using the photoelectrical inverter in the operation gestalt 1 of this invention. <u>Drawing 2</u> is the shift register for 8 bits and the circuit block diagram of a photo detector in <u>drawing 1</u>. <u>Drawing 3</u> is the representative circuit schematic of the photo detector for 4 pixels in a photoelectrical inverter. <u>Drawing 4</u> is a timing chart which shows actuation of <u>drawing 2</u>.

[0035] As shown in <u>drawing 1</u>, the photoelectrical inverter 1 and 1' are multi-mounted, and the contact type image sensor is formed. In addition, although only a part for two chips is illustrated to <u>drawing 1</u>, 15 chips are multi-mounted actually and the contact type image sensor is constituted.

[0036] Common connection of Clock CLK and the start pulse SP which drive it, and the resolution switch signal MODE is made at the photoelectrical inverter 1 and 1'. Moreover, read-out start signal SI of a line sensor is inputted into the image-sensors chip 1. When the resolution switch signal MODE is high-level, it is considering as the configuration from which the resolution of for example, high resolution mode 600dpi is

obtained. Moreover, in the case of a low level, it is considering as the configuration from which the resolution of for example, low resolution mode 300dpi is obtained.

[0037] furthermore -- photoelectricity -- an inverter -- one -- one -- ' -- four -- bit -- delay -- having -- pre -- a shift register -- two -- ' -- a shift register -- three -- ' -- 344 -- a bit -- a photo detector -- an array -- four -- ' -- timing -- generating -- a circuit -- five -- ' -- a signal -- an output -- amplifier -- a block -- six -- six -- having -- **** . Here, a shift register 3 and 3' are equipped with the shift register block 11 for 4 bits.

[0038] Moreover, by the shift register 3 and the shift signal of 3', through the switch switch on / switch off, reading appearance of the photo detector array 4 and the picture signal received by 4' is carried out to a signal output line, and it is amplified by the signal output amplifier block 6 and 6'. Then, it is switched by the control signal of the timing generating circuit 5 and 5', and is outputted as a signal output Vout.
[0039] The signal output amplifier block 6 and 6' are connected with the resolution switch signal (MODE) line. The signal output amplifier block 6 and 6' are equipped with a means to change an amplification factor, according to the resolution switched by the MODE signal. Detail of the signal output amplifier block 6 and 6' is given later.

[0040] Moreover, the start signal 9-1 at the time of high resolution mode, 9' - 1 and the start signal 9-2 at the time of a low resolution, 9' - It is considering as the configuration from which the chip [degree] start signal 9 and 9' are obtained by choosing 2 using the start signal switch means 10 and 10'. Moreover, the chip [degree] start signal 9 and 9' output the signal at the time before [a bit of] N (K-N bit) as a start signal of degree chip from this side N bit parts of a shift register 3 and the last register of 3' from the time of the bit of each photoelectrical inverter 1 and 1' ending read-out.

[0041] moreover -- a clock signal -- CLK -- a start pulse -- a signal -- SP -- driving -- having -- timing -- generating -- a circuit -- five -- '-- a photo detector -- four -- '-- driving -- a pulse -- and -- a shift register -- three -- '-- driving -- a driving pulse -- seven -- '-- and -- eight -- '-- generating -- having . The start pulse signal SP is connected for taking the synchronization of initiation of each image-sensors chip of operation common to each image-sensors chip.

[0042] <u>Drawing 2</u> is the circuit block diagram of the shift register for 8 bits, and a photo detector. The shift register block 11 which makes 4 bits 1 block is equipped with the shift register. Namely, the shift register block 11 is equipped with 1 bit-shift register 12-1 to 12-4 synchronous [phi1], the analog switches S11-S17 which switch 1 bit-shift register 13-1 to 13-4 and a mode signal synchronous [phi2], and S21-S27. [0043] Moreover, the shift register block 11 is connected with photo detectors a1-d1 and each switch control terminal between the signal output lines which are not illustrated through the read-out pulse line phia1 to

[0044] <u>Drawing 3</u> is a drawing in which the equal circuit for 4 pixels of photo detectors in <u>drawing 2</u> is shown. Each photo detectors a1-d1 of <u>drawing 3</u> are equipped with photo diode PDa-PDd used as a photo-electric-translation means, read-out switch M1 a-M1d, signal transfer switch M2 a-M2d, MOS source follower M3 a-M3d, reset switch M4 a-M4d that is a means to reset a photo-electric-translation means, and storage capacitance calcium-Cd which accumulates a charge temporarily.

[0045] The signal output of each photo detectors a1-d1 is outputted to the common signal line 14. And it is amplified with the signal output amplifier block 6, and is outputted from an output terminal Vout. The signal output amplifier block 6 is equipped with the input-buffer amplifier 6-1 which carries out impedance conversion of the output of the common output line 14, the gain amplifier 6-2 which carries out parallel connection of the resistance to a reversal terminal, and inputs and amplifies the output of the input-buffer amplifier 6-1 from a noninverting terminal, and the gain adjustable means 6-3 which carries out adjustable [of the gain of the gain amplifier 6-2] in this operation gestalt.

[0046] The gain adjustable means 6-3 is constituted using an analog switch, and is equipped with a reference electrical potential difference. And an analog switch is switched according to the resolution switch control signal (MODE) inputted. In connection with it, the resistance connected to the gain amplifier 6-2 is also switched. Therefore, the electrical potential difference according to resolution is inputted into the reversal terminal of the gain amplifier 6-2. Therefore, the signal output amplifier block 6 can acquire a resolution switch control signal (MODE), i.e., the amplifier gain according to resolution.

[0047] Hereafter, actuation of this operation gestalt is explained. In each photo detectors a1-d1 shown in drawing 3, a charge is transformed into an electrical potential difference by MOS source follower M3 a-M3d, and the optical carrier generated by photo electric translation in photo diode PDa-PDd is transmitted to storage capacitance calcium-Cd by all pixel coincidence in signal transfer pulse phiT. it continues and becomes yes from a shift register 11 one by one -- reading appearance is carried out, reading appearance is

carried out one by one, switch M1 a-M1d is made into an ON state, and reading appearance of the signal level is carried out to the common signal line 14 by the pulse phia1 to phid1 as a capacitive component rate. [0048] In this operation gestalt, although it reads at the time of high resolution mode and the pulse phia1 to phid1 carries out sequential ON, at the time of low resolution mode, adjoining 2 bits, phia1 [i.e.,] which are scanned from a shift register 11, and phib1 turn on simultaneously, and it becomes the configuration which phic1 and phid1 turn on simultaneously continuously.

[0049] Therefore, in low resolution mode, 2-pixel capacitive component rate addition enables it to make a signal level larger than the time of high resolution mode. In addition, about the above-mentioned capacitive component rate addition, it is indicated by JP,4-4682,A, for example.

[0050] Below, <u>drawing 2</u> and <u>drawing 4</u> are used and actuation of the shift register section is explained. In <u>drawing 2</u>, when a MODE signal is high-level, the analog switch of S11, S21, S16, S17, S26, and S27 will be in an OFF state, and, on the other hand, S12, S13, S14, S15, S22, S23, S24, and S25 will be in an ON state.

[0051] Therefore, it will become the usual shift register actuation without a resolution switch, and phid2 will be from the read-out control pulse phia1 each photo detector a1 - for d1 in an ON state one by one serially. In addition, in <u>drawing 2</u>, although the output line of a picture signal is not illustrated, synchronizing with becoming sequential yes by phid2 from a control pulse phia1, the light-receiving charge of d2 is outputted to a signal output line from each photo detector a1.

[0052] Next, when a MODE signal is a low level, the analog switch of S11, S21, S16, S17, S26, and S27 will be in an ON state, and, on the other hand, S12, S13, S14, S15, S22, S23, S24, and S25 will be in an OFF state. Therefore, if a shift pulse is inputted into a shift register 12-1, it will be outputted by phia1 and phib1phi1 synchronization from a shift register 12-1, and a signal with photo detectors a1 and b1 will be read simultaneously.

[0053] Continuing, it is inputted into a shift register 13-2 through an analog switch S11, phic1 and phid1 are outputted by phi2 synchronization from a shift register 13-2, and a shift pulse reads simultaneously a signal with photo detectors c1 and d1. Reading appearance of the addition charge of a pair of photo detector is carried out to the output line which does not illustrate in the mode of low resolution read-out one by one like a photo detector a1, b1 and c1, d1 and a2, and b2, c2 and d2.

[0054] At this time, since a shift pulse is not inputted, a shift register 13-1 and a shift register 12-2 do not operate. Similarly, phia2 and phib2 are outputted by phi1 synchronization from a shift register 12-3, a signal with photo detectors a2 and b2 is read simultaneously, it is outputted by phic2 and phid2phi2 synchronization from a shift register 13-4, and a signal with photo detectors c2 and d2 is read simultaneously.

[0055] The timing chart of the above actuation is shown in <u>drawing 4</u>. In <u>drawing 4</u>, a clock signal CLK and synchronizing signals phi1 and phi2 are supplied common to high resolution mode and low resolution mode, and while start signal SR becomes yes, each picture signal output in high resolution mode and low resolution mode is obtained. <u>drawing 4</u> shows that the twice [at the time of high resolution mode] as many thing which reading appearance is carried out and is read at a rate as this is possible in low resolution mode in the same clock rate.

[0056] Below, the switch means of a chip [degree] start signal is explained. In <u>drawing 1</u>, since the pre shift register 2 and 2' have 4-bit delay, they must output the signal in front of 4 bits as a start signal of degree chip. Therefore, in the case of high resolution mode, since the photoelectrical inverter 1 and 1' are equipped with a 344-bit signal, respectively, the bit [341st] shift register signal 9-1 and 9'-1 are used for them as a chip [degree] start signal, for example.

[0057] Moreover, in low resolution mode, since a 2-pixel addition signal becomes 1 bit, the photoelectrical inverter 1 and 1' will output a 177-bit signal equivalent. Therefore, the bit [337th] shift register signal 9-2 and 9'-2 are used as a chip [degree] start signal by photo detector conversion. That is, by establishing the start signal switch means which switches a chip [degree] start signal, even if it switches resolution, in the part of the photoelectrical inverter 1 and 1', a pixel signal can maintain a continuity.

[0058] In addition, in this operation gestalt, although the number of bits of a photoelectrical inverter was made into 344 bits, if it is the number of bits of the multiple of 4, it will not matter without limit. Moreover, resolution, such as not only when [high resolving mode / low resolving mode] is [600dpi / 300dpi], but [400dpi/200dpi] etc., is sufficient also as resolution.

[0059] Furthermore, although this operation gestalt showed the case where the resolution ratio in high resolution mode and low resolution mode was twice, a resolution ratio can also be set up 3 times like a switch of [600dpi / 200dpi] by making 6 pixels into 1 block and, for example, making the number of pixels

of a photoelectrical inverter into the multiple of 6.

[0060] Moreover, by not being restricted to this and changing the configuration of a shift register, although the shift register driving pulse is explained as two, when a low resolution is chosen, three adjacent photo detectors are added and it can read by three shift register driving pulses.

[0061] The gain adjustable means 6-3 which uses <u>drawing 3</u> again and serves as the description of this invention next is explained. In <u>drawing 3</u>, although the signal on the common output line 14 is amplified with the signal output amplifier block 6, a resolution switch signal (MODE) is connected to the signal output amplifier block 6, and the gain of the gain amplifier 6-2 is considering it as the configuration which changes with gain adjustable means 6-3 according to the resolution inputted from a MODE terminal. In this operation gestalt, by changing the resistance ratio by R1-R3 of the gain amplifier 6-2 using an analog switch shows the example to which gain is changed. <u>drawing 4</u> -- setting -- the amplifier gain at the time at the time (MODE=Hi) of high resolution mode, and the gain of the gain amplifier 6-2 at the time at the time (MODE=Lo) of low resolution mode -- respectively -- G600 and G300 ** -- if it carries out -- G600= (R1+R2)/R2G300=(R1+R2//R3)/(R2//R3)

It becomes.

[0062] In this operation gestalt, a constant called R1=18.0komegaR2=2.0komegaR3=4.5kohm is used, therefore an amplifier gain called G600=10G300=14 can be obtained, for example.

[0063] On the other hand, it sets in this operation gestalt. The capacity value CT of storage capacitance calcium-Cd, and the capacity value CH of the common output line 14 The value of CT-2.0pFCH=3.0pF is used. Therefore, a capacitive component rate ratio It is set to 2CT/(2CT+CH) = 2x2/(2x2+3) = 0.571 at the time of the time (MODE=Lo) of CT/(CT+CH)=2-/(2+3) =0.400 low-resolution mode at the time of the time (MODE=Hi) of high resolution mode.

[0064] Therefore, the product of the amplifier gain 6-2 and capacitive component rate ratio in each at the time of low resolution mode and high resolution mode It is set to 10x0.4=414x0.571=7.994, and the ratio of the product of an amplifier gain 6-2 and a capacitive component rate ratio can obtain equivalent signal level, even if the storage time at the time of low resolution mode is set to one half at the time of high resolution mode in clock rate regularity, since it becomes twice [about].

[0065] In addition, in this operation gestalt, although the resistance by the side of the reference supply of the gain amplifier 6-2 is changed, resistance of an output side may be changed. Moreover, in this operation gestalt, although the gain of the single gain amplifier 6-2 is changed, two or more gain amplifier with which gain differs beforehand may be formed, and the configuration which chooses gain amplifier so that desired gain may be acquired by the resolution control signal (MODE) may be used.

[0066] In this operation gestalt, although resolution is set to 600dpi/300dpi, resolution, such as 400dpi/200dpi, is sufficient, for example. Furthermore, although this operation gestalt showed the case where the resolution ratio in high resolution mode and low resolution mode was twice, a resolution ratio can also be set up 3 times like a switch of 600dpi/200dpi by making 6 pixels into 1 block and, for example, making the number of pixels of a photoelectrical inverter into the multiple of 6.

[0067] Moreover, the selecting switch which chooses either of two or more resolution as an image scanner and facsimile, and an electronic copying machine, Make into a main scanning direction the direction which reads a contact type image sensor, and a direction vertical to the main scanning direction is made into the direction of vertical scanning. By acquiring a scan scanning circuit and a two-dimensional reading signal also in the direction of vertical scanning structural corresponding to an image manuscript, and forming the aligner exposed to an optical photo conductor according to this reading signal According to two or more resolution, it can imprint on transferred paper, and a functional degree of freedom can be increased. [0068] (Operation gestalt 2) The contact type image sensor using the photoelectrical inverter in the 2nd operation gestalt of this invention is explained using <u>drawing 5</u> and <u>drawing 6</u>. <u>Drawing 5</u> is the representative circuit schematic of the photo detector for 4 pixels in the photoelectrical inverter in this operation gestalt. Moreover, <u>drawing 6</u> is the representative circuit schematic of the signal output amplifier block 6 in this operation gestalt. In addition, in this operation gestalt, it is considering as the same configuration as <u>drawing 3</u> except photo detector configuration and signal output amplifier block, and reset switch 15.

[0069] <u>Drawing 5</u> is an equal circuit for 4 pixels of photo detectors in <u>drawing 2</u>. In <u>drawing 5</u> each photo detectors al-dl Photo diode PDa-PDd, read-out switch M1 aS-M1dS, and M1 aN-M1dN used as a photo-electric-translation means, Lightwave signal transfer switch M2 aS-M2dS, noise signal transfer switch M2 aN-M2dN, It has MOS source follower M3 a-M3d, reset switch M4 a-M4d which are a means to reset a photo-electric-translation means, lightwave signal storage capacitance CaS-CdS which accumulates a

lightwave signal temporarily, and noise storage capacitance CaN-CdN which accumulates a noise signal. [0070] <u>Drawing 6</u> is the representative circuit schematic of the signal output amplifier block 6 in this operation gestalt. As shown in <u>drawing 6</u>, the signal output amplifier block 6 is equipped with the input-buffer amplifier 6-1 which carries out impedance conversion of the output of the lightwave signal common output line 14-1 and the noise signal common output line 14-2, the differential amplifier 6-4 which takes the difference of the output of two input-buffer amplifier 6-1, the gain amplifier 6-2 which amplifies the output of the differential amplifier 6-4, and the gain adjustable means 6-3 which carries out adjustable [of the gain of the gain amplifier 6-2].

[0071] Moreover, like the operation gestalt 1, the resolution switch control signal (MODE) is connected and the gain adjustable means 6-3 can obtain the amplifier gain according to resolution.

[0072] Hereafter, actuation of this operation gestalt is explained. If light carries out incidence to each photo detectors a1-d1, photo diode PDa-PDd will carry out photo electric translation of the ****, will consider as a lightwave signal output and a noise signal output, and will be outputted to MOS source follower M3 a-M3d.

[0073] MOS source follower M3 a-M3d transforms a charge into an electrical potential difference, and transmits it to storage capacitance CaS-CdS and storage capacitance CaN-CdN by all pixel packages in signal transfer pulse phiTS and signal transfer pulse phiTN.

[0074] it continues and becomes yes from a shift register 11 one by one -- reading appearance is carried out, reading appearance is carried out one by one, switch M1 aS-M1dS and M1 aN-M1dN are made into an ON state, and reading appearance of a lightwave signal electrical potential difference and the noise signal level is carried out to the lightwave signal common signal line 14-1 and the noise signal common signal line 14-2 by the pulse phia1 to phid1.

[0075] Impedance conversion of the lightwave signal electrical potential difference and noise signal level by which reading appearance was carried out is carried out with each input-buffer amplifier 6-1. And in the differential amplifier 6-4, the differential output voltage which carried out difference of the noise signal output voltage from lightwave signal output voltage, for example, was amplified 5 times is outputted. Then, with the gain amplifier 6-2, the output of the differential amplifier 6-4 is amplified 4 times, and it is outputted from an output terminal Vout. Moreover, the amplifier gain according to resolution can be obtained with the resolution switch control signal (MODE) connected to the signal output amplifier block 6. [0076] this operation gestalt -- setting -- each photo detectors a1-d1 -- the lightwave signal storage capacitance CaS and the noise signal storage capacitance CaN -- preparing -- further -- the difference -- since it is processing with the differential amplifier 6-4, FPN resulting from the threshold variation of MOS source follower M3a prepared in each pixel can be controlled.

[0077] In addition, in this operation gestalt, R1=18.0Kohm which is the same constant as the operation gestalt 1, R2=2.0Kohm, and R3=4.5Kohm are used about the capacity value of storage capacitance, the capacity value of the noise signal common output line 14-2 and the capacity value of the lightwave signal common output line 14-1, and the resistance R1, R2, and R3 of gain amplifier (6-2).

[0078] moreover, the gain adjustable means 6-3 changes the resistance ratio used for the differential amplifier 6-4 -- making -- although you may prepare, since the resistance ratio of a noise signal system and the resistance ratio of a lightwave signal system are influenced by the analog switch of the gain adjustable means 6-3 of the variation in ON resistance in this case, nonconformities, such as buildup of FPN, may arise as a result. therefore, it is shown in <u>drawing 6</u> -- as -- difference -- it is more desirable to form the gain adjustable means 6-3 in the part of the gain amplifier 6-2 after processing.

[0079] Moreover, in this operation gestalt, when nonconformity, like actuation of the gain amplifier 6-2 becomes instability, or actuation becomes slow arises by changing the gain of the gain amplifier 6-2, the means of changing the constant current section in amplifier to which a phase compensation capacitance value is changed may be used similarly, using a resolution switch control signal (MODE).

[0080] (Operation gestalt 3) The contact type image sensor using the photoelectrical inverter in the 3rd operation gestalt of this invention is explained using <u>drawing 5</u> and <u>drawing 7</u>. <u>Drawing 7</u> is the representative circuit schematic of the signal output amplifier block in the photoelectrical inverter in the contact type image sensor using the photoelectrical inverter in this operation gestalt. The photoelectrical inverter of this operation gestalt is considered as the same configuration as the photoelectrical inverter explained in the operation gestalt 2 except the signal output amplifier block.

[0081] Impedance conversion of the output of the lightwave signal common output line 14-1 and the output of the noise signal common output line 14-2 is carried out through the input-buffer amplifier 6-1. then, the differential amplifier 6-4 -- the difference of a lightwave signal and a noise signal -- it processes, for

example, is amplified by 5 times as many gain as this. And the output of the differential amplifier 6-4 is inputted into the gain adjustable means 6-3.

[0082] Here, the gain adjustable means 6-3 has established the switching means 6-5 which can be switched to the signal path into which the output of the differential amplifier 6-4 is inputted by the gain amplifier 6-2 through gain amplifier 6-2' with a resolution switch control signal (MODE), and the signal path as which the output of the differential amplifier 6-4 is inputted into the direct gain amplifier 6-2. The analog switch of MOS etc. can be used for this switching means 6-5.

[0083] Moreover, in this operation gestalt, the gain of the differential amplifier 6-4 of this operation gestalt has set up the gain of the gain amplifier 6-2 of 5 times and the output section 4 times using the value as the operation gestalt 2 with the same constant of a photo detector (not shown). Moreover, the gain of gain amplifier 6-2' of an intermediate stage is set up 1.4 times. The gain of the signal output amplifier block 6 becomes 28 times at the time of the time (MODE=Lo) of 20 time low resolution mode at the time of the time (MODE=Hi) of high resolution mode.

[0084] Even if this operation gestalt changes the gain of the signal output amplifier block 6, since the property of amplifier 6-2 and 6-2' does not change, it can realize stable actuation. In addition, in the photoelectrical inverter explained in the operation gestalten 1-3, although what made resolution two, a low resolution and high resolution, was explained, what is equipped with three or more resolution and can perform the resolution switch according to the number of resolution may be used.

[0085] For example, if it has three resolution and those resolution is switched, the output of every one photo detector, the addition output from two photo detectors, and the addition output from four photo detectors can be performed by changing the circuitry of the shift register block 11. And what is necessary is just to control a gain adjustable means according to resolution.

[0086] Therefore, the photoelectrical inverter corresponding to two or more resolution is realizable by changing the circuitry of the shift register block 11.

[0087] (Operation gestalt 4) The image reader of this operation gestalt is explained using <u>drawing 8</u> - <u>drawing 10</u>. <u>Drawing 8</u> is planar structure drawing of an image reader equipped with the contact type image sensor constituted using the photoelectrical inverter shown in the operation gestalt 1. <u>Drawing 9</u> is the sectional view of a contact type image sensor. <u>Drawing 10</u> is a timing chart which shows actuation of a contact type image sensor.

[0088] As shown in <u>drawing 8</u>, the image-sensors module is constituted by multi-mounting the photoelectrical inverter 1-1 to 1-15 in the shape of in-line ones by for example, 15 chips on the ceramic mounting substrate 32. Each photoelectrical inverter 1-1 to 1-15 is connected with wiring on the mounting substrate 32 through the bonding wire.

[0089] In this operation gestalt, only start signal SI which operates the shift register of 1 chip eye, chip [degree] start signal SO of the shift register of 15 chip eye, and the signal output line Vout and each input terminal of a resolution switch control signal (MODE) are illustrated. And these input terminals support each input/output terminal explained in <u>drawing 1</u>. In addition, explanation of other input/output terminals is omitted.

[0090] The contact type image sensor shown in <u>drawing 9</u> has formed the chip coat agent 33 which consists of silicone resin etc., and the case 37 for protection of the lens array 34 which condenses the LED light source 35 which irradiates red and a green and blue light, and the reflected light from a manuscript to the base material 36 of light transmission nature and a base material 36, and carries out image formation on a photo detector front face, the photoelectrical inverter 1 on the ceramic substrate 32 which carries out photo electric translation of the reflected light condensed by the lens array 34, and the photoelectrical inverter 1. Adhesion mold image sensors are constituted by assembling these.

[0091] The image reader 40 is equipped with the contact type image sensor 38, the signal-processing means, the sensor driving means, and the LED luminescence means (an LED driving means is included). Actuation of that is controlled by supplying start signal SI and the resolution control signal MODE to a contact type image sensor 38 as a sensor driving signal from a sensor driving means. In addition, the clock signal etc. is not illustrated, for example.

[0092] Moreover, the output signal Vout of a contact type image sensor 38 is connected to the signal-processing means, in a signal-processing means, processing of A/D conversion, a shading compensation, dark amendment, color composition, etc. is added, and a final picture signal is generated.

[0093] Furthermore, LED with which the contact type image sensor 38 was equipped is connected with the LED flash control means, and burning and a flash are controlled by chip [degree] start signal SO of the shift register of 15 chip eye supplied from start signal SI and the photoelectrical inverter with which an LED

flash control means is supplied from a sensor driving means.

[0094] Therefore, while the LED light source 35 is emitting light only in red, the photoelectrical inverter 1 is driven and red information is read, it continues, and reading of a color copy can be similarly performed by reading green and blue information and compounding the color information on these manuscripts using an image processing, without using a light filter.

[0095] In this operation gestalt, chip [degree] start signal SO of the shift register of 15 chip eye is further used as a signal which controls burning termination of the LED light source 35 using start signal SI of 1 chip eye transmitted from a means to control actuation of a contact type image sensor, as a signal which controls burning initiation of the LED light source 35. Therefore, only while all the photoelectrical inverters 1-1 to 1-15 of mounting substrate top 32 are operating, the LED light source 35 will be on.

[0096] <u>Drawing 10</u> is a timing chart which shows the above-mentioned actuation. In <u>drawing 10</u>, (1) shows actuation of the LED light source 35 at the time of high resolution mode. Moreover, (2) shows actuation of the LED light source 35 at the time of low resolution mode. As shown in <u>drawing 10</u>, when resolution is switched to low resolution mode from high resolution mode using the actuation clock of constant frequency, the burning period of each LED light source 35 and about 1/of periods to start signal SI- degree chip start signal SO are set to 2. Therefore, the output level of a lightwave signal also declines.

[0097] However, as shown in the operation gestalten 1-3, since the photoelectrical inverter is equipped with the gain switch means 6-3 (<u>drawing 6</u> etc.), it cannot be based on resolution but can obtain an almost fixed signal output.

[0098] Furthermore, in the photoelectrical inverter constituted as mentioned above, when a resolution switch control signal (MODE) performs a resolution switch, according to resolution, the burning period of the LED light source 35 can be automatically controlled to the optimum value corresponding to a part for sensibility change of a photoelectrical inverter. Therefore, burning control of the LED light source 35 becomes simple. In addition, since it is not based on resolution, but it is fixed and the channel range of A/D-conversion equipment can be used when performing signal processing, for example for the output of a contact type image sensor using A/D-conversion equipment etc., cheap adhesion mold image sensors can be offered. [0099] Moreover, although this operation gestalt showed light source switch mold color adhesion mold image sensors as an example, it is applicable not only to a light source switch mold but a monochrome contact type image sensor etc.

[0100]

[Effect of the Invention] The image-sensors unit of this invention makes the Mitsuteru gunner stage switch off with the photo-electric-translation signal which is outputted from a photoelectrical inverter in resolution at the time of a switch in addition to the thing which were embraced in resolution, and for which lowering of the output level of a photo-electric-translation signal is prevented even if it reads, and it realizes a rate and it speeds up [reading], as explained above.

[0101] It becomes unnecessary therefore, to, equip the image reader using these image sensors with a means to make the Mitsuteru gunner stage switch off, for example. Therefore, system cost can be reduced.

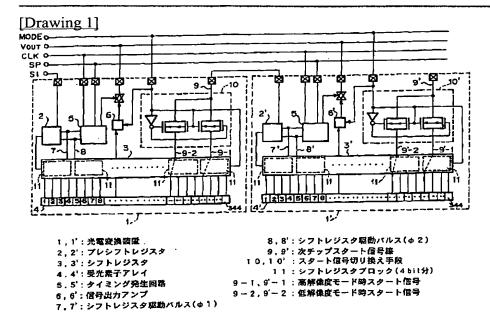
[Translation done.]

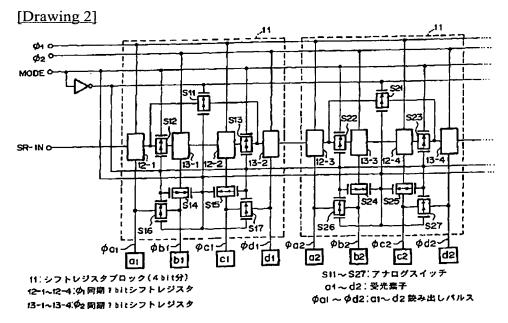
* NOTICES *

JPO and NCIPI are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

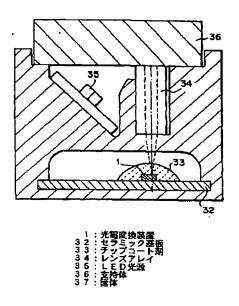
- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

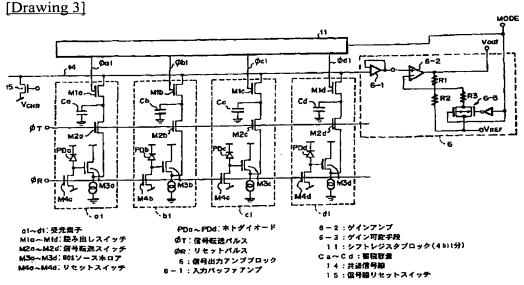
DRAWINGS

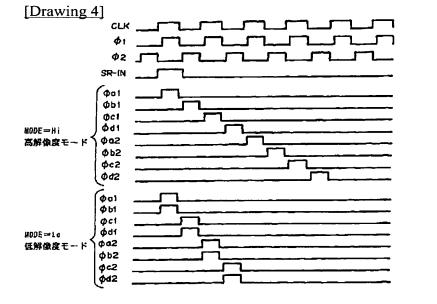




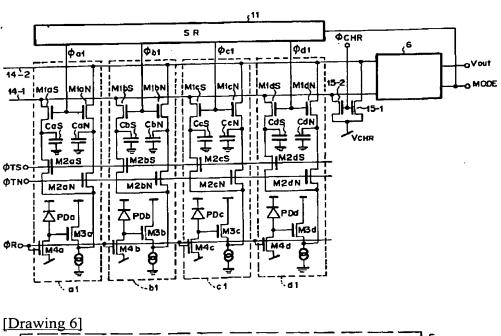
[Drawing 9]

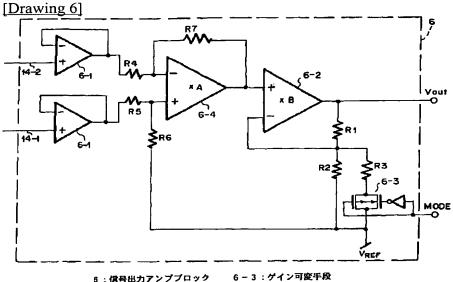






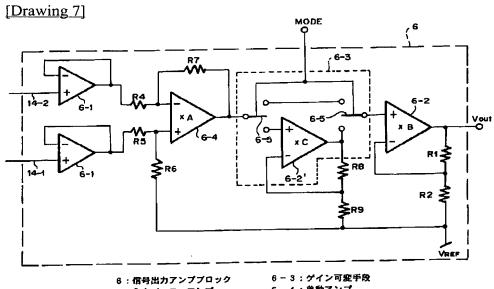
[Drawing 5]



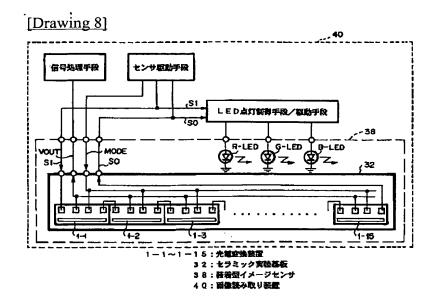


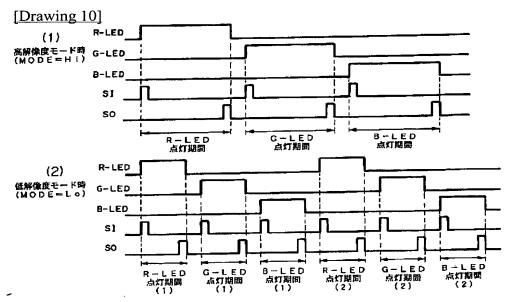
6:信号出力アンプブロック 6-3:ゲイン可変 6-1:入力パッファアンプ 6-4:差励アンプ

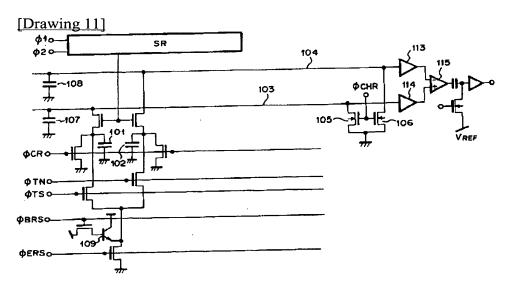
6-2:ゲインアンプ



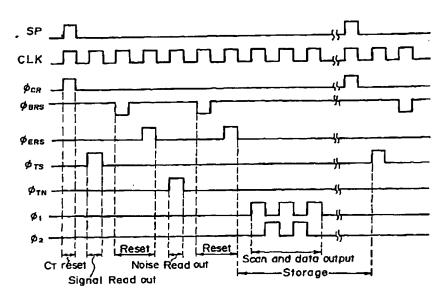
6-4: 急動アンプ 6-4: 急動アンプ 6-2: ゲインアンプ 6-5: スイッチ手段

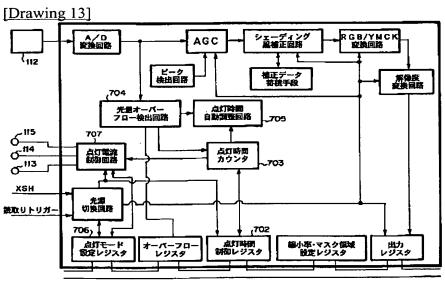


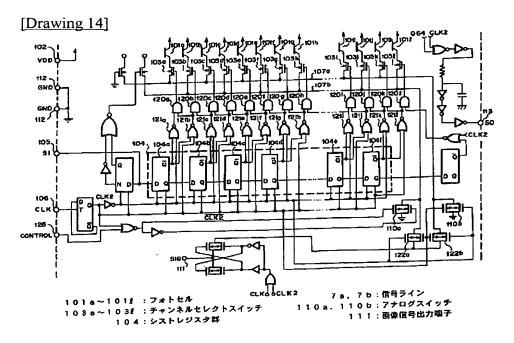




[Drawing 12]







'[Translation done.]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-299764 (P2000-299764A)

(43)公開日 平成12年10月24日(2000.10.24)

(51) Int.CL7		識別記号	FΙ		5	7] h* (参考)
H 0 4 N	1/04	101	H04N	1/04	101	5 C O 5 1
	1/028			1/028	Α	5 C 0 7 2
	1/409			1/40	101C	5 C O 7 7

審査請求 未請求 請求項の数12 OL (全 17 頁)

		香蕉明水	木明水 明水県の数12 OL (主 17 貝)
(21)出顧番号	特顧平11-105497	(71)出顧人	000001007
			キヤノン株式会社
(22)出顧日	平成11年4月13日(1999.4.13)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(72)発明者	小塚開
		-	東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
			ノン株式会社内
	•	(74)代理人	100065385
			弁理士 山下 穣平
		1	•

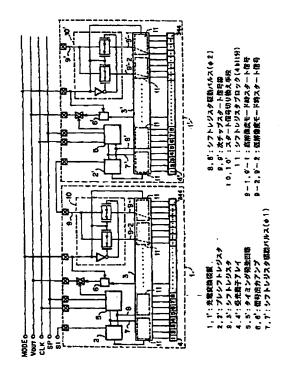
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 イメージセンサユニット及びそれを用いた画像読み取り装置

(57)【要約】

【課題】 解像度を切り換え時に、解像度に応じた読み 取り速度を実現し、かつ読み取り速度を速めても光電変 換信号の出力レベルの低下を防止し、加えて安価なイメ ージセンサユニットを提供することを課題とする。

【解決手段】 原稿に光を照射する光照射手段と、前記原稿からの光を入射する複数の光電変換手段を有する光電変換装置とを備えるイメージセンサユニットにおいて、前記光照射手段は、前記光電変換装置と共に駆動を開始し、前記光電変換装置から出力される光電変換信号を入力すると、前記駆動を終了する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 原稿に光を照射する光照射手段と、前記 原稿からの光を入射する複数の光電変換手段を有する光 電変換装置とを備えるイメージセンサユニットにおい て、

前記光照射手段は、前記光電変換装置と共に駆動を開始 し、前記光電変換装置から出力される光電変換信号を入 力すると、前記駆動を終了することを特徴とするイメー ジセンサユニット。

【請求項2】 前記光照射手段は、LEDであることを 10 特徴とする請求項1に記載のイメージセンサユニット。

【請求項3】 前記光電変換装置は、第1の解像度と前 、記光電変換手段により変更された第2の解像度とを切り 換える解像度切り換え手段と、前記解像度切り換え手段 における解像度の切り換えを制御する解像度制御手段 と、前記光電変換手段から出力された光電変換信号を前 記解像度制御手段によって制御される増幅率にしたがっ て増幅する増幅手段とを備えることを特徴とする請求項 1に記載のイメージセンサユニット。

【請求項4】 前記光電変換装置は、前記光電変換手段 20 からノイズ信号を読み出して保持するノイズ信号保持手 段と、

前記光電変換手段から光信号を読み出して保持する光信 号保持手段と

前記ノイズ信号保持手段から出力される複数のノイズ信 号をノイズ信号共通出力線に読み出す第1読み出し手段

前記光信号保持手段から出力される複数の光信号を光信 号共通出力線に読み出す第2読み出し手段と、

前記第1読み出し手段及び第2読み出し手段により、前 30 記光電変換手段により変更された画像信号の解像度を切 り換える解像度切り換え手段と、

前記解像度切り換え手段における解像度の切り換えを制 御する解像度制御手段と、

前記ノイズ信号と前記光信号との差分をとる差分手段

前記差分手段から出力された光電変換信号を前記解像度 制御手段によって制御される増幅率にしたがって増幅す る増幅手段とを備えることを特徴とする請求項1に記載 のイメージセンサユニット。

【請求項5】 前記第1の解像度のときの前記増幅率を G1とし、前記第2の解像度のときの前記増幅率をG2 とした場合に、

G2>G1であることを特徴とする請求項3に記載のイ メージセンサユニット。

【請求項6】 前記ノイズ信号保持手段は容量値CTNの 容量を備え、前記光信号保持手段は容量値CTSの容量を 備え、かつ、CTS≒CTN≒CTであり、

前記ノイズ信号共通出力線は容量値CHNの寄生容量を備

え、かつ、CHN≒CHS≒CHであり、

さらに、前記第1の解像度のときの前記増幅率をG1と し、前記第2の解像度のときの前記増幅率をG2とした 場合、

 $G 2/G 1 = (N \times C_T + C_H) / (C_T + C_H)$

であることを特徴とする請求項5に記載のイメージセン サユニット。

【請求項7】 原稿に光を照射する光照射手段と、前記 原稿からの光を入射する複数の光電変換手段を有する光 電変換装置とを備えるイメージセンサユニットと、

前記イメージセンサを駆動するセンサ駆動手段とを備え た画像読み取り装置において、

前記イメージセンサユニットは、前記駆動手段から出力 される駆動開始信号により駆動を開始し、

前記光照射手段は、前記光電変換装置から出力される光 電変換信号を入力すると、前記駆動を終了することを特 徴とする画像読み取り装置。

【請求項8】 前記光照射手段は、LEDであることを 特徴とする請求項7に記載の画像読み取り装置。

【請求項9】 前記光電変換装置は、第1の解像度と前 記光電変換手段により変更された第2の解像度とを切り 換える解像度切り換え手段と、前記解像度切り換え手段 における解像度の切り換えを制御する解像度制御手段 と、前記光電変換手段から出力された光電変換信号を前 記解像度制御手段によって制御される増幅率にしたがっ て増幅する増幅手段とを備えることを特徴とする請求項 7に記載の画像読み取り装置。

【請求項10】 前記光電変換装置は、前記光電変換手 段からノイズ信号を読み出して保持するノイズ信号保持 手段と、

前記光電変換手段から光信号を読み出して保持する光信 号保持手段と、

前記ノイズ信号保持手段から出力される複数のノイズ信 号をノイズ信号共通出力線に読み出す第1読み出し手段 と、

前記光信号保持手段から出力される複数の光信号を光信 号共通出力線に読み出す第 2 読み出し手段と、

前記第1読み出し手段及び第2読み出し手段により、前 記光電変換手段により変更された画像信号の解像度を切 り換える解像度切り換え手段と、

前記解像度切り換え手段における解像度の切り換えを制 御する解像度制御手段と、

前記ノイズ信号と前記光信号との差分をとる差分手段

前記差分手段から出力された光電変換信号を前記解像度 制御手段によって制御される増幅率にしたがって増幅す る増幅手段とを備えることを特徴とする請求項7に記載 の画像読み取り装置。

【請求項11】 前記第1の解像度のときの前記増幅率 え、前記光信号共通出力線は容量値CHSの寄生容量を備 50 をG1とし、前記第2の解像度のときの前記増幅率をG

(3)

2とした場合に、

G2>G1であることを特徴とする請求項9に記載の画 像読み取り装置。

【請求項12】 前記ノイズ信号保持手段は容量値 C_{TN} の容量を備え、前記光信号保持手段は容量値 C_{TS} の容量を備え、かつ、 C_{TS} $\stackrel{+}{=}$ C_{TN} $\stackrel{+}{=}$ C_{T} であり、

前記ノイズ信号共通出力線は容量値C_{HN}の寄生容量を備え、前記光信号共通出力線は容量値C_{HS}の寄生容量を備え、かつ、C_{HN}≒ C_{HS}≒ C_Hであり、

さらに、前記第1の解像度のときの前記増幅率をG1と 10 し、前記第2の解像度のときの前記増幅率をG2とした 場合、

G 2 / G 1 = (N × C_T + C_H) / (C_T + C_H) であることを特徴とする請求項 1 1 に記載の画像読み取り装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、たとえば、ファクシミリ、イメージスキャナ、ディジタル複写機等の画像読み取り装置及びそれに用いるイメージセンサユニット 20 に関し、特に解像度切り換え機能を有する光電変換装置と光源を含むイメージセンサユニット及び画像読み取り装置の光源の点灯期間制御に関わるものである。

[0002]

【従来の技術】近年、光電変換装置の分野においては、
CCDの他に各画素にバイポーラトランジスタを増幅素子として設けたBASIS、各画素にMOSトランジスタを増幅素子として設けた増幅型の光電変換装置(たとえば特開平1-154678号公報)等が提案されている。このような増幅型の光電変換装置においては、各画素に設けている増幅素子のバラツキが固定パターンノイズのことであり、ターンノイズと定義する。、【0011】以下に、従来ズ(Fixed Pattern Noise:以下、FPNと称する。)となるという問題があり、FPN除去方法に関して、さまざまな提案がなされている。

【0003】(従来技術1) FPN除去方法の1つとして、光信号(S信号)と暗状態の信号(N信号)との差分をとることにより、増幅素子のバラツキを補正する方法が提案されている。このFPN補正手法を図11、図12に示す。

【0004】図11は光電変換装置を各画素に有する1 40 次元の光電変換装置の1bit分の回路図、図12はそ のタイミングチャートである(テレビジョン学会誌 V ol. 47、No9(1993)pp. 1180)。

【0005】図11に示す回路動作、及びFPN除去について説明する。まず、光信号保持容量CTS101、ノイズ信号保持容量CTN102をリセットし、つぎに、センサであるバイポーラトランジスタ109にベースに光量に応じた電荷を受光する。そして、受光した電荷の蓄積が終了した後、ノイズを含む光信号を光信号保持容量CTS101に転送する。

4

【0006】つづいて、バイポーラトランジスタ109のリセット動作を行い、ノイズ信号をノイズ信号保持容量CTN102に転送する。そして、再度、センサのリセット動作を行って蓄積動作にはいる。また、蓄積動作中にシフトレジスタが走査を開始する。

【0007】まず、最初に光信号共通出力線103及びノイズ信号共通出力線104をリセットMOS105、106を用いてリセットした後、光信号保持容量CTS101、ノイズ信号保持容量CTN102のデータを、共通出力線103、104にそれぞれ共通出力線容量CHS107、共通出力線容量CHN108との容量分割にて出力する。

【0008】ここで、共通出力線容量 $C_{HS}107$ 、 $C_{IN}108$ は各共通出力線の容量であるが、以後、光信号共通出力線を C_{HN} と定義する。その後、再び共通出力線容量 $C_{HS}107$ 、共通出力線容量 $C_{HN}108$ をリセットして、図示しない次の画素の光信号保持容量 C_{TN} のデータを読み出す。

「0009】この動作を繰り返してすべての画素の信号を出力する。出力された信号はそれぞれボルテージホロア113、114を介して差動アンプ115に入力され光電変換装置の出力となる。ここで、チップ内のFPNは主に各画素のバイポーラトランジスタ109のhFEなどのバラツキに起因するものが主であり、上記のS-N方式により、画素ごとのhFEバラツキに起因するFPNを除去することが可能となる。

【0010】なお、ここでいうFPNは暗時の固定パターンノイズのことであり、以降、FPNは暗時の固定パターンノイズを完善する

【0011】以下に、従来技術におけるFPN除去について説明する。

【0012】図11において、光信号共通出力線103 の信号(Sout)及びノイズ信号共通出力線104の 信号(Nout)は次式であらわされる。

[0013]

Sout = $(V_S \times C_{TS}) + (V_{CHS} \times C_{HS}) / (C_{TS} + C_{HS})$

Nout = $(V_N \times C_{TN}) + (V_{CHR} \times C_{HN}) / (C_{TN} + C_{HN})$

ここで、

 V_N : ノイズ信号読み出し時のノイズ信号蓄積容量 C_{TS} の電圧、

 V_S : 光信号読み出し時の光信号蓄積容量 C_{TS} の電圧、である。 すなわち、光信号成分の電圧を V_{SIG} とすると、 $V_S = V_{SIG} + V_N$ となる。

【0014】(1)、(2)式において、

 $C_{HS} = C_{HN} = C_{H}$

V_S=V_N=V_{CT}(暗時)

 $C_{TS} = C_{TN} = C_T$

であるならば、上記の差分信号は Sout-Nout=0となる。

【0015】また、Vsが、所定の光量を受けた場合、 $V_S = V_{SIG} + V_N \ge x \delta \le 2$ ≥ 5 $\le V_{SIG} = V_{SIG} + V_N - 1$ VNから真の光信号成文のみを読み出すことができる。 したがって、仮にVCTが画素ごとにばらついていたとし ても、(1)、(2)式の差分信号はOとなるためFP Nが除去できることになるとしている。

【0016】(従来技術2)上記従来技術1は受光素子 としてバイポーラトランジスタを用いた例であるが、バ イポーラトランジスタの代わりに、ホトダイオードとM OSアンプを用いた光電変換装置が、たとえば特開平9 -205588号公報に提案されている。

【0017】この公報においては、画素ごとに設けたM OSソースホロアのしきい値バラツキに起因するFPN は、従来技術1のFPN除去回路を用いて低減すること ができることが開示されている。

【0018】 (従来技術3) 例えば、特開平10-12 6575号公報には、光源切り換え型のイメージセンサ を用いた画像形成装置、制御方法及びシステムが提案さ れている。

【0019】図13は、上記公報に掲載されている画像 形成装置を示す図である。この画像形成装置は、まず、 異なる波長の光を複数のLED光源113,114,1 15から照射する。照射された画像は、読み取りセンサ 112が読みとる場合に、画像を単一色で読みとる第1 のモードと複数色で読みとる第2のモードとを、点滅モ ード設定レジスタ706が切り換える。また、光源11 3, 114, 115の点灯時間が点灯時間制御レジスタ 702、点灯時間カウンタ703、点灯時間自動調整回 路705により設定され、光源113,114,115 に供給される電流が点灯電流制御回路707により設定 される。そして、CPUがモードに応じてこれらの制御 を行う。

【0020】(従来技術4) さらに、解像度切り換え方 式の光電変換装置については、たとえば、特開平5-2 27362号公報には、新規に解像度制御用のコントロ ール端子を設け、ユーザが利用条件にあわせて解像度を 切り換えることが可能な密着型イメージセンサが提案さ れている。図14は、当該公開公報に提案されている密 着型イメージセンサ用集積回路の回路図である。

【0021】この従来技術においては、イメージセンサ チップにコントロール端子(125)を設け、その端子 にユーザが、ハイレベル又はローレベルの信号を入力す ることにより解像度切り換えを実現している。図14に ついて概略説明すれば、スタートパルスSIとクロック パルスCLKとにより、シフトレジスタ104が起動さ れると、その出力はノアゲート121、アンドゲート1 20を通ってチャンネルセレクトスイッチ103に入力 50 の制御系に解像度切り換え時を含むすべての動作モード

され、これをオンにし、フォトセル101からの信号を 信号ライン107に取り出す。

【0022】ここで、コントロール信号入力端子125 に入力する信号の"H"又は、"L"によって、アナロ グスイッチ110aなどが切り換えられ、画像出力端子 111に16ドット/ミリ又は、8ドット/ミリの読み 取り密度で画像信号が得られる。つまり、センサIC上 のフォトセル101a~1011は常に全数が動作して いるが、外部に出力画像信号を取り出す際に、コントロ ール信号によって一部を間引いて出力させることができ るとしている。

[0023]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上記の従来技 術4に開示されている密着型イメージセンサの解像度切 り換え方式においては、画素を読み飛ばすことにより解 像度を切り換えている。そのため、解像度が通常の場合 でも、解像度を半分にした場合でも、双方のクロックレ ートが同一の場合には、読み出し時間は変わらない。

【0024】仮に、受光素子が600dpiの光学解像 度で配置され、高解像度モードで600dpi、低解像 度モードで300dpiの解像度が得られるとすると、 たとえば、600dpi時に6msec/lineの読 み取り速度が得られる場合、300dpi時でも6ms e c/lineの読み取り速度となり、解像度を落とし ても読み取り速度が変わらない。すなわち、解像度に応 じた読み取り速度を実現することができないという問題 がある。

【0025】ここで、読み取り速度は、ほぼ容量の蓄積 時間に相当する。そのため、300dpi時の蓄積時間 は600dpi時の蓄積時間の約半分となる。したがっ て、容量に蓄積する電荷量も少ない。よって、低解像度 の場合に、高解像度の場合と同様の光出力の強さを得る ためには、読み出しゲインの2倍にする必要がある。

【0026】しかし、たとえば、容量分割による画素加 算においては、2画素分割加算を行う場合、読み出しゲ インの比は、

 $\{2C_T/(2C_T+C_H)\}/\{C_T/(C_T+C_H)\}=$ $(C_T + C_H) / (C_T + C_H / 2) < 2$

となる。すなわち、読み出しゲインは2未満となる。

【0027】上記の例を一般化すると、N画素分の容量 分割加算により、解像度を1/Nに切り換える場合に は、蓄積時間が1/Nとなるため、解像度切り換え時に おいても同様の信号出力を得るためには、N倍の読み出 しゲインが必要となるが、読み出しゲインの比は、

 ${NC_T / (NC_T + C_H)} / {C_T / (C_T + C_H)} =$ $(C_T + C_H) / (C_T + C_H/N) < N$

となり、N倍の読み出しゲインを得ることはできない。 【0028】また、従来技術3は、解像度切り換えモー ドのないイメージセンサユニットの制御系であるが、こ

7

においておのおののパラメータを制御する場合、システムが複雑となり、コストの高いものとなる場合がある。

【0029】すなわち、従来技術においては、安価に、 解像度切り換え時に同等の光出力信号レベルを得られる 画像読み取り装置を提供することができない場合があ る。

【0030】そこで、本発明は、解像度を切り換え時に、解像度に応じた読み取り速度を実現し、かつ読み取り速度を速めても光電変換信号の出力レベルの低下を防止し、加えて安価なイメージセンサユニット及びそれを 10 用いた画像読み取り装置を提供することを課題とする。

[0031]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するために、本発明は、原稿に光を照射する光照射手段と、前記原稿からの光を入射する複数の光電変換手段を有する光電変換装置とを備えるイメージセンサユニットにおいて、前記光照射手段は、前記光電変換装置と共に駆動を開始し、前記光電変換装置から出力される光電変換信号を入力すると、前記駆動を終了する。

【0032】また、本発明は、原稿に光を照射する光照 20 射手段と、前記原稿からの光を入射する複数の光電変換 手段を有する光電変換装置とを備えるイメージセンサユニットと、前記イメージセンサを駆動するセンサ駆動手段とを備えた画像読み取り装置において、前記イメージセンサユニットは、前記駆動手段から出力される駆動開始信号により駆動を開始し、前記光照射手段は、前記光電変換装置から出力される光電変換信号を入力すると、前記駆動を終了する。

[0033]

【発明の実施の形態】以下、図面を用いて、本発明の実 30 施形態について説明する。

【0034】 [実施形態1] 図1は、本発明の実施形態1における光電変換装置を用いた密着型イメージセンサの回路ブロック図である。図2は、図1における8ビット分のシフトレジスタと受光素子の回路ブロック図である。図3は、光電変換装置内の4画素分の受光素子の等価回路図である。図4は、図2の動作を示すタイミングチャートである。

【0035】図1に示すように、光電変換装置1,1'がマルチ実装され、密着型イメージセンサが形成されて 40いる。なお、図1には2チップ分のみを図示しているが、実際にはたとえば15チップをマルチ実装して密着型イメージセンサを構成している。

【0036】光電変換装置1,1'には、それを駆動するクロックCLK、スタートパルスSP及び解像度切り換え信号MODEが共通接続されている。また、ラインセンサの読み出しスタート信号SIがイメージセンサチップ1に入力されている。解像度切り換え信号MODEがハイレベルの場合には、たとえば高解像度モード600dpiの解像度が得られる構成としている。また、ロ50

8

ーレベルの場合には、たとえば低解像度モード300d piの解像度が得られる構成としている。

【0037】さらに、光電変換装置1,1'は、4bitの遅延を有するプレシフトレジスタ2,2'と、シフトレジスタ3,3'と、344ビットの受光素子アレイ4,4'と、タイミング発生回路5,5'と、信号出力アンプブロック6,6とを備えている。ここで、シフトレジスタ3,3'は、4ビット分のシフトレジスタブロック11を備えている。

【0038】また、受光素子アレイ4、4′で受光された画像信号は、シフトレジスタ3,3'のシフト信号によって、オン/オフするスイッチを介して、信号出力線に読み出され、信号出力アンプブロック6、6′で増幅される。そうして、タイミング発生回路5、5′の制御信号によってスイッチングされて信号出力Voutとして出力される。

【0039】信号出力アンプブロック6、6′は、解像 度切り換え信号 (MODE) 線と接続されている。信号 出力アンプブロック6、6′は、MODE信号により切り換えられる解像度に応じて、増幅率を変化させる手段 を備えている。信号出力アンプブロック6、6′の詳細 は後に述べる。

【0040】また、高解像度モード時のスタート信号9-1,9'-1及び低解像度時のスタート信号9-2,9'-2を、スタート信号切り換え手段10,10'を用いて選択することにより、次チップスタート信号9,9'が得られる構成としている。また、次チップスタート信号9、9'は、各光電変換装置1、1'のビットが読み出しを終了するときよりNビット前(K-Nビット)時の信号を、シフトレジスタ3、3'の最終レジスタの手前Nビット部分から次チップのスタート信号として出力する。

【0041】また、クロック信号CLKとスタートパルス信号SPとで駆動されるタイミング発生回路5、5′により、受光素子4、4′を駆動するパルス及びシフトレジスタ3、3′を駆動する駆動パルス7、7′及び8、8′が生成される。スタートパルス信号SPが各イメージセンサチップに共通に接続されているのは、各イメージセンサチップの動作開始の同期をとるためである。

【0042】図2は、8ビット分のシフトレジスタと受 光素子との回路ブロック図である。シフトレジスタは、4ビットを1ブロックとするシフトレジスタブロック11に備えられている。すなわち、シフトレジスタブロック11は、Φ1同期の1ビットシフトレジスタ12-1~12-4と、Φ2同期の1ビットシフトレジスタ13-1~13-4及びモード信号を切り換えるアナログスイッチS11~S17と、S21~S27とを備えている。

【0043】また、シフトレジスタブロック11は、読

み出しパルス線Φa1~Φd1を介して、受光素子a1 ~d1と図示しない信号出力線間の各スイッチ制御端子 と接続されている。

【0044】図3は、図2における受光素子4画素分の 等価回路を示す図面である。図3の各々の受光素子 a 1 ~d1は、光電変換手段となるホトダイオードPDa~ PDdと、読み出しスイッチM1a~M1dと、信号転 送スイッチM2a~M2dと、MOSソースホロアM3 a~M3dと、光電変換手段をリセットする手段である リセットスイッチM4a~M4dと、一時的に電荷を蓄 10 積する蓄積容量Ca~Cdとを備えている。

【0045】各々の受光素子a1~d1の信号出力は、 共通信号線14に出力される。そして、信号出力アンプ プロック6で増幅されて、出力端子Voutから出力さ れる。本実施形態において、信号出力アンプブロック6 は、共通出力線14の出力をインピーダンス変換する入 カバッファアンプ6-1と、反転端子に抵抗を並列接続 し、非反転端子から入力バッファアンプ6-1の出力を 入力し増幅するゲインアンプ6-2と、ゲインアンプ6 -2のゲインを可変するゲイン可変手段6-3とを備え 20

【0046】ゲイン可変手段6-3は、たとえば、アナ ログスイッチを用いて構成され、リファレンス電圧を備 える。そして、入力される解像度切り換え制御信号(M ODE) に応じてアナログスイッチが切り換えられる。 それに伴い、ゲインアンプ6-2に接続される抵抗も切 り換えられる。したがって、解像度に応じた電圧がゲイ ンアンプ6-2の反転端子に入力される。そのため、信 号出力アンプブロック6は、解像度切り換え制御信号

(MODE)、すなわち、解像度に応じたアンプゲイン 30 を得ることができる。

【0047】以下、本実施形態の動作について説明す る。図3に示す各受光素子a1~d1において、ホトダ イオードPDa~PDdにて光電変換により生成した光 キャリアは、MOSソースホロアM3a~M3dで電荷 は電圧に変換され、信号転送パルスΦTにて全画素一致 にて蓄積容量Ca~Cdに転送される。つづいて、シフ トレジスタ11から順次ハイとなる読み出しパルスΦa 1~Φd1によって、順次読み出しスイッチM1a~M 1 dをオン状態にし、共通信号線14に信号電圧が容量 分割として読み出される。

【0048】本実施形態においては、高解像度モード時 には読み出しパルス Φa1~Φd1は順次オンしていく が、低解像度モード時には、隣接する2ビット、すなわ ちシフトレジスタ11から走査するΦa1とΦb1とが 同時にオンし、つづいてΦclとΦdlとが同時にオン する構成となる。

【0049】したがって、低解像度モードにおいては2 画素の容量分割加算により、信号電圧を高解像度モード 時より大きくすることが可能となる。なお、上記の容量 50 スタ2、2'は、たとえば、4ビットの遅延を有するた

10

分割加算については、たとえば、特開平4-4682号 公報に開示されている。

【0050】つぎに、図2、図4を用いてシフトレジス タ部の動作を説明する。図2において、MODE信号が ハイレベルの場合は、S11、S21、S16、S1 7、S26、S27のアナログスイッチがオフ状態とな り、一方、S12、S13、S14、S15、S22、 S23、S24、S25がオン状態となる。

【0051】したがって、解像度切り換えのない、通常 のシフトレジスタ動作となり、各受光素子a1~d1用 の読み出し制御パルスΦalからΦd2までは時系列的 に順次オン状態となる。なお、図2においては、画像信 号の出力線を図示していないが、制御パルスΦalから Φ d 2 による順次ハイとなるのに同期して、各受光素子 a 1 から d 2 の受光電荷が信号出力線に出力される。

【0052】つぎに、MODE信号がローレベルの場合 は、S11、S21、S16、S17、S26、S27 のアナログスイッチがオン状態となり、一方、S12、 S13, S14, S15, S22, S23, S24, S 25がオフ状態となる。したがって、シフトレジスタ1 2-1にシフトパルスが入力されると、シフトレジスタ 12-1からΦa1とΦb1とがΦ1同期で出力され、 受光素子a1とb1との信号を同時に読み出す。

【0053】つづいて、シフトパルスは、アナログスイ ッチS11を介してシフトレジスタ13-2に入力さ れ、シフトレジスタ13-2からΦc1とΦd1とが、 Φ2同期で出力され、受光素子c1とd1との信号を同 時に読み出す。低解像度読み出しのモードの場合も、図 示しない出力線に受光素子a1とb1、c1とd1、a 2とb2、c2とd2というように、対の受光素子の加 算電荷が順次読み出される。

【0054】このとき、シフトレジスタ13-1及びシ フトレジスタ12-2は、シフトパルスが入力されない ため動作しない。同様に、シフトレジスタ12-3から Φa2とΦb2とが、Φ1同期で出力され、受光素子a 2とb2との信号を同時に読み出し、シフトレジスタ1 3-4から Φ c 2と Φ d 2とが Φ 2同期で出力され、受 光素子c2とd2との信号を同時に読み出す。

【0055】以上の動作のタイミングチャートを図4に 示す。図4において、クロック信号CLKと、同期信号 Φ1, Φ2が高解像度モードと低解像度モードとに共通 に供給され、スタート信号SRがハイとなると共に高解 像度モードと低解像度モードとのそれぞれの画像信号出 力が得られる。図4より、同一のクロックレートにおい て、低解像度モードにおいては、高解像度モード時の2 倍の読み出し速度で読み出すことが可能であることがわ かる。

【0056】つぎに、次チップスタート信号の切り換え 手段について説明する。図1において、プレシフトレジ 11

め、4 ビット前の信号を次チップのスタート信号として 出力しなければならない。したがって、高解像度モード の場合には、光電変換装置1、1 は、たとえば、それ ぞれ3 4 4 ビットの信号を備えるため、3 4 1 ビット目 のシフトレジスタ信号9-1、9 1 1 を次チップスタート信号として用いる。

【0057】また、低解像度モードにおいては、2画素加算信号が1ビットとなるため、光電変換装置1、1′は等価的に177ビットの信号を出力することになる。したがって、受光素子換算で337ビット目のシフトレジスタ信号9-2、9′-2を次チップスタート信号として用いる。すなわち、次チップスタート信号を切り換えるスタート信号切り換え手段を設けることにより、解像度を切り換えても光電変換装置1、1′の継ぎ目の部分において画素信号は連続性を保つことができる。

【0058】なお、本実施形態においては、光電変換装置のビット数を344ビットとしたが、4の倍数のビット数であれば幾つでも構わない。また、解像度も[高解像モード/低解像モード]が[600dpi/300dpi]の場合に限らず、たとえば、[400dpi/2 2000dpi]などの解像度でも構わない。

【0059】さらに、本実施形態は高解像度モードと低解像度モードの解像度比が2倍の場合を示したが、たとえば、6画素を1ブロックとし、光電変換装置の画素数を6の倍数とすることで、[600dpi/200dpi]の切り換えのように、解像度比を3倍に設定することもできる。

【0060】また、シフトレジスタ駆動パルスを、2つとして説明しているが、これに限られるものではなくシフトレジスタの構成を変えることにより、たとえば、3 30つのシフトレジスタ駆動パルスでは、低解像度が選択された場合には隣り合う3つの受光素子を加算して読み出すようにすることもできる。

【0061】つぎに、再び図3を用いて本発明の特徴となるゲイン可変手段6-3について説明する。図3において、共通出力線14上の信号は、信号出力アンプブロック6にて増幅されるが、信号出力アンプブロック6には解像度切り換え信号(MODE)が接続され、MODE端子から入力される解像度に応じて、ゲインアンプ6-2のゲインがゲイン可変手段6-3により変化する構成としている。本実施形態においては、アナログスイッチを用いてゲインアンプ6-2のR1~R3による抵抗比を変化させることにより、ゲインを変化させる例を示す。図4において、高解像度モード時(MODE=Hi)のときのアンプゲイン及び低解像度モード時(MODE=Lo)のときのゲインアンプ6-2のゲインを、それぞれG600、G300とすると、

 G_{600} = (R1+R2) /R2 G_{300} = (R1+R2//R3) / (R2//R3) となる。 12

【0062】本実施形態においては、たとえば、

 $R1=18.0k\Omega$

 $R2=2.0k\Omega$

 $R3=4.5k\Omega$

という定数を用いており、したがって、

 $G_{600} = 10$

 $G_{300} = 14$

というアンプゲインを得ることができる。

【0063】一方、本実施形態において、蓄積容量Ca ~Cdの容量値CTと共通出力線14の容量値CHは、

 $C_T = 2$. OpF

 $C_H=3.0pF$

という値を用いており、したがって、容量分割比は、 高解像度モード時(MODE=Hi)時 $C_T/(C_T+C_H)=2/(2+3)=0.400$ 低解像度モード時(MODE=Lo)時 $2C_T/(2C_T+C_H)=2\times2/(2\times2+3)=0.571$ となる。

【0064】したがって、低解像度モード時と高解像度 モード時のそれぞれにおける、アンプゲイン6-2と容 量分割比との積は、

 $1.0 \times 0.4 = 4$

 $14 \times 0.571 = 7.994$

となり、アンプゲイン6-2と容量分割比との積の比は、約2倍となるため、クロックレート一定の場合、低解像度モード時の蓄積時間が高解像度モード時の1/2となっても、同等の信号レベルを得ることができる。

【0065】なお、本実施形態においては、ゲインアンプ6-2の基準電源側の抵抗を変化させているが、出力側の抵抗を変化させてもよい。また、本実施形態においては、単一のゲインアンプ6-2のゲインを変化させているが、あらかじめゲインの異なる複数のゲインアンプを設け、解像度制御信号(MODE)によって所望のゲインが得られるようにゲインアンプを選択する構成を用いてもよい。

【0066】本実施形態においては、解像度を600d pi/300dpiとしているが、たとえば、400d pi/200dpiなどの解像度でもよい。さらに、本実施形態は高解像度モードと低解像度モードとの解像度比が2倍の場合を示したが、たとえば、6画素を1ブロックとし、光電変換装置の画素数を6の倍数とすることで、600dpi/200dpiの切り換えのように、解像度比を3倍に設定することもできる。

【0067】また、イメージスキャナ及びファクシミリ、電子複写機として、複数の解像度のいずれかを選択する選択スイッチと、密着型イメージセンサを読み出す方向を主走査方向とし、その主走査方向に垂直な方向を副走査方向として、機構的に副走査方向にも画像原稿に50 対応して走査走査回路と、2次元状の読み取り信号を得

1.3

て、この読み取り信号に応じて光学感光体に露光する露 光装置とを設けることにより、複数の解像度に応じて被 転写紙に転写することができ、機能的な自由度を増加す ることができる。

【0068】 (実施形態2) 本発明の第2の実施形態に おける光電変換装置を用いた密着型イメージセンサにつ いて図5、図6を用いて説明する。図5は、本実施形態 における光電変換装置内の4 画素分の受光素子の等価回 路図である。また、図6は、本実施形態における信号出 カアンプブロック6の等価回路図である。なお、本実施 形態においては、受光素子構成及び信号出力アンプブロ ック、リセットスイッチ15以外は図3と同様の構成と している。

【0069】図5は、図2における受光素子4画素分の 等価回路である。図5において、各々の受光素子a1~ d 1は、光電変換手段となるホトダイオードPDa~P Dd、読み出しスイッチM1 a S~M1 d S及びM1 a N~M1dN、光信号転送スイッチM2aS~M2d S、ノイズ信号転送スイッチM2aN~M2dN、MO SソースホロアM3a~M3d、光電変換手段をリセッ トする手段であるリセットスイッチM4a~M4d、一 時的に光信号を蓄積する光信号蓄積容量CaS~Cd S、ノイズ信号を蓄積するノイズ蓄積容量CaN~Cd Nとを備えている。

【0070】図6は、本実施形態における信号出力アン プブロック6の等価回路図である。図6に示すように、 信号出力アンプブロック6は、光信号共通出力線14-1及びノイズ信号共通出力線14-2の出力をインピー ダンス変換する入力バッファアンプ6-1と、2つの入 カバッファアンプ6-1の出力の差をとる差動アンプ6 - 4と、差動アンプ6-4の出力を増幅するゲインアン プ6-2と、ゲインアンプ6-2のゲインを可変するゲ イン可変手段6-3とを備える。

【0071】また、ゲイン可変手段6-3は、実施形態 1と同様に、解像度切り換え制御信号 (MODE) が接 続されており、解像度に応じたアンプゲインを得ること ができる。

【0072】以下、本実施形態の動作について説明す る。各受光素子a1~d1に光が入射すると、ホトダイ オードPDa~PDdは、そ光を光電変換して光信号出 40 力及びノイズ信号出力として、MOSソースホロアM3 a ~M3 d に出力する。

【0073】MOSソースホロアM3a~M3dは、電 荷を電圧に変換して、信号転送パルスΦTS及び信号転 送パルスΦTNにて、全画素一括で蓄積容量CaS~C dS及び蓄積容量CaN~CdNに転送する。

【0074】つづいて、シフトレジスタ11から順次ハ イとなる読み出しパルスΦal~Φdlによって、順次 読み出しスイッチM1aS~M1dS及びM1aN~M 1 d Nをオン状態にして、光信号共通信号線14-1及 50 ズ信号共通出力線14-2の出力は、入力バッファアン

びノイズ信号共通信号線14-2に、光信号電圧及びノ イズ信号電圧が読み出される。

【0075】読み出された光信号電圧及びノイズ信号電 圧は、各々の入力バッファアンプ6-1により、インピ ーダンス変換される。そして、差動アンプ6-4におい て、光信号出力電圧からノイズ信号出力電圧を差分さ れ、たとえば、5倍に増幅した差動出力電圧が出力され る。その後、ゲインアンプ6-2で差動アンプ6-4の 出力を、たとえば、4倍に増幅して出力端子Voutよ り出力される。また、信号出力アンプブロック6に接続 されている解像度切り換え制御信号(MODE)によ り、解像度に応じたアンプゲインを得ることができる。 【0076】本実施形態においては、各々の受光素子a 1~d1に光信号蓄積容量CaS、ノイズ信号蓄積容量 CaNを設け、さらにその差分処理を差動アンプ6-4 にて行っているため、各画素に設けたMOSソースホロ アM3aのしきい値バラツキに起因するFPNを抑制す ることができる。

【0077】なお、本実施形態においては、蓄積容量の 容量値、ノイズ信号共通出力線14-2の容量値及び光 信号共通出力線14-1の容量値、ゲインアンプ(6-2) の抵抗値R1、R2、R3については、実施形態1 と同様の定数である、たとえば、R1=18.0KΩ、 R2=2. $0K\Omega$ 、R3=4. $5K\Omega$ を用いている。 【0078】また、ゲイン可変手段6-3は、差動アン プ6-4に用いている抵抗比を変化させるようにを設け ても構わないが、この場合、ノイズ信号系の抵抗比と光 信号系の抵抗比が、ゲイン可変手段6-3のアナログス イッチのON抵抗のバラツキの影響を受けるため、結果 としてFPNの増大などの不具合が生じる可能性があ る。したがって、図6に示すように、差分処理を行った 後のゲインアンプ6-2の部分にゲイン可変手段6-3 を設けるのがより好ましい。

【0079】また、本実施形態において、ゲインアンプ 6-2のゲインを変化させることにより、ゲインアンプ 6-2の動作が不安定になる、もしくは動作が遅くなる などの不具合が生じる場合は、同様に解像度切り換え制 御信号(MODE)を用いて、たとえば、位相補償容量 値を変化させる、アンプ内の定電流部を変化させるなど の手段を用いてもよい。

【0080】 (実施形態3) 本発明の第3の実施形態に おける光電変換装置を用いた密着型イメージセンサにつ いて図5、図7を用いて説明する。図7は本実施形態に おける光電変換装置を用いた密着型イメージセンサにお ける光電変換装置内の信号出力アンプブロックの等価回 路図である。本実施形態の光電変換装置は、信号出力ア ンププロック以外は実施形態2において説明した光電変 換装置と同様の構成としている。

【0081】光信号共通出力線14-1の出力及びノイ

20

1.5

プ6-1を介してインピーダンス変換される。その後、 差動アンプ6-4で光信号とノイズ信号の差分処理を行 い、たとえば、5倍のゲインで増幅される。そして、差 動アンプ6-4の出力は、ゲイン可変手段6-3に入力 される。

【0082】ここで、ゲイン可変手段6-3は、解像度 切り換え制御信号 (MODE) により、差動アンプ6-4の出力を、ゲインアンプ6-2'を介してゲインアン プ6-2に入力される信号経路と、差動アンプ6-4の 出力が直接ゲインアンプ6-2に入力される信号経路と に切り換えることができるスイッチ手段6-5を設けて いる。このスイッチ手段6-5には、たとえば、MOS のアナログスイッチなどを用いることができる。

【0083】また、本実施形態において、受光素子(図 示せず)の定数は、実施形態2と同様の値を用い、本実 施形態の差動アンプ6-4のゲインは、たとえば、5 倍、出力部のゲインアンプ6-2のゲインは、たとえ ば、4倍に設定している。また、中間段のゲインアンプ 6-2' のゲインは、たとえば、1. 4倍に設定してい る。信号出力アンプブロック6のゲインは、

高解像度モード時(MODE=Hi)時には、20倍 低解像度モード時 (MODE=Lo) 時には、28倍 となる。

【0084】本実施形態は、信号出力アンプブロック6 のゲインを変化させても、アンプ6-2、6-2,の特 性は変化しないため、安定な動作を実現することができ る。なお、実施形態1から3において説明した光電変換 装置においては、解像度を低解像度と高解像度との2つ にしたものを説明したが、3つ以上の解像度を備え、解 像度数に応じた解像度切り換えを行えるものでもよい。 【0085】たとえば、3つの解像度を備え、それらの

解像度を切り換えるとすれば、シフトレジスタブロック 11の回路構成を変更することにより、1つの受光素子 ずつの出力、2つの受光素子からの加算出力、4つの受 光素子からの加算出力を行えるようになる。そして、解 像度に応じてゲイン可変手段を制御すればよい。

【0086】したがって、シフトレジスタブロック11 の回路構成を換えることにより複数の解像度に対応した 光電変換装置を実現することができる。

【0087】(実施形態4)本実施形態の画像読み取り 装置について、図8~図10を用いて説明する。図8は たとえば実施形態1に示した光電変換装置を用いて構成 した密着型イメージセンサを備える画像読み取り装置の 平面構造図である。図9は密着型イメージセンサの断面 図である。図10は密着型イメージセンサの動作を示す タイミングチャートである。

【0088】図8に示すように、セラミック実装基板3 2上に、光電変換装置1-1~1-15を、たとえば1 5 チップ分インライン状にマルチ実装することにより、

16

変換装置1-1~1-15は、ボンディングワイヤを介 して実装基板32上の配線と接続されている。

【0089】本実施形態においては、1チップ目のシフ トレジスタを動作させるスタート信号SIと、15チッ プ目のシフトレジスタの次チップスタート信号SOと、 信号出力線Voutと、解像度切り換え制御信号(MO DE) の各入力端子のみを図示している。そして、これ らの入力端子は、図1において説明した各々の入出力端 子に対応している。なお、他の入出力端子の説明は省略 する。

【0090】図9に示す密着型イメージセンサは、光透 過性の支持体36と、支持体36に赤色・緑色・青色の 光を照射するLED光源35と、原稿からの反射光を集 光し受光素子表面で結像させるレンズアレイ34と、レ ンズアレイ34により集光された反射光を光電変換する セラミック基板32上の光電変換装置1と、光電変換装 置1の保護のため、シリコーン樹脂などからなるチップ コート剤33と、筐体37とを設けている。これらを組 み立てることにより密着型イメージセンサを構成してい る、

【0091】画像読み取り装置40は、密着型イメージ センサ38、信号処理手段、センサ駆動手段及びLED 発光手段(LED駆動手段を含む)を備えている。セン サ駆動手段からセンサ駆動信号として、スタート信号S I、解像度制御信号MODEが密着型イメージセンサ3 8に供給されることにより、それの動作が制御される。 なお、たとえばクロック信号などは図示していない。

【0092】また、密着型イメージセンサ38の出力信 号Voutは、信号処理手段に接続されており、信号処 理手段において、たとえばA/D変換、シェーディング 補正、ダーク補正、色合成等の処理を加えて最終的な画 像信号が生成される。

【0093】さらに、密着型イメージセンサ38に備え られたLEDは、LED点滅制御手段と接続されてお り、LED点滅制御手段は、センサ駆動手段から供給さ れるスタート信号SI及び光電変換装置から供給される 15チップ目のシフトレジスタの次チップスタート信号 SOにより、点灯と点滅とが制御される。

【0094】したがって、LED光源35が、赤色のみ を発光しているとき、光電変換装置1を駆動して赤色情 報を読み取り、つづいて同様に、緑色及び青色の情報を 読み取り、これらの原稿の色情報を画像処理を用いて合 成することにより、カラーフィルタを用いることなくカ ラー原稿の読み取りができる。

【0095】本実施形態においては、LED光源35の 点灯開始を制御する信号として、密着型イメージセンサ の駆動を制御する手段から送信されでくる1チップ目の スタート信号SIを用い、さらに、LED光源35の点 灯終了を制御する信号として、15チップ目のシフトレ イメージセンサモジュールを構成している。各々の光電 50 ジスタの次チップスタート信号SOを用いている。した

17

がって、実装基板上32のすべての光電変換装置1-1 ~1-15が動作している間のみLED光源35が点灯 していることになる。

【0096】図10は、上記の動作を示すタイミングチャートである。図10において、(1)は、高解像度モード時のLED光源35の動作を示している。また、

(2)は、低解像度モード時のLED光源35の動作を示している。図10に示すように、一定周波数の駆動クロックを用いて、高解像度モードから低解像度モードに解像度を切り換えた場合には、各々のLED光源35の 10点灯期間及びスタート信号SI~次チップスタート信号SOまでの期間は約1/2になる。そのため、光信号の出力レベルも低下する。

【0097】しかし、実施形態 $1\sim3$ に示すように、光電変換装置はゲイン切り換え手段6-3(図6など)を備えているため、解像度によらず、ほぼ一定の信号出力を得ることができる。

【0098】さらに、上記のように構成した光電変換装置において、解像度切り換え制御信号(MODE)によって解像度切り換えを行う場合、解像度に応じてLED 20光源35の点灯期間を自動的に光電変換装置の感度変化分に対応した最適値に制御することができる。そのため、LED光源35の点灯制御が簡便となる。加えて、たとえば密着型イメージセンサの出力をA/D変換装置などを用いて信号処理を行う場合においても、A/D変換装置の入力レンジを解像度によらず一定で使用することができるため、安価な密着型イメージセンサを提供することができる。

【0099】また、本実施形態は、光源切り換え型カラー密着型イメージセンサを例として示したが、光源切り 30換え型に限らず、白黒の密着型イメージセンサなどにも適用できる。

[0100]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のイメージセンサユニットは、解像度を切り換え時に、解像度に応じた読み取り速度を実現して、かつ読み取り速度を速めても光電変換信号の出力レベルの低下を防止することに加え、光電変換装置から出力される光電変換信号によって、光照射手段を消灯させる。

【0101】そのため、たとえば、このイメージセンサ 40 を用いた画像読み取り装置は、光照射手段を消灯させる 手段を備える必要がなくなる。したがって、システムコストを低減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態1における光電変換装置及び 密着型イメージセンサの回路ブロック図である。

【図2】本発明の実施形態1における8ビット分のシフトレジスタと受光素子の回路ブロック図である。

【図3】本発明の実施形態1における受光素子の等価回路図(4画素分)である。

18

【図4】本発明の実施形態1におけるシフトレジスタと 受光素子との回路動作を示すタイミングチャートであ ろ

【図5】本発明の実施形態2における光電変換装置の受 光素子の回路ブロック図である。

【図6】本発明の実施形態2における信号出力アンプブロック回路ブロック図である。

【図7】本発明の実施形態3における光電変換装置の信号出力アンプブロックの回路ブロック図である。

【図8】本発明の実施形態4における密着型イメージセンサのイメージセンサモジュール部の平面図である。

【図9】本発明の実施形態4における密着型イメージセンサの断面図である。

【図10】本発明の実施形態4における密着型イメージ センサの光源のタイミングチャートである。

【図11】従来技術1の光電変換装置の等価回路図である。

【図12】従来技術1の光電変換装置のタイミングチャ ートである。

【図13】従来技術3における密着型イメージセンサ用 集積回路の回路図である。

【図14】従来技術4における密着型イメージセンサ用 集積回路の回路図である。

【符号の説明】

- 1、1′ 光電交換装置
- 2、2′ プレシフトレジスタ
- 3、3′シフトレジスタ
- 4、4′ 受光素子アレイ
- 5、5′タイミング発生回路
- 6、6′ 信号出力アンプブロック
 - 6-1 入力パッファアンプ
 - 6-2 ゲインアンプ
 - 6-4 差動アンプ
 - 7、7' シフトレジスタ駆動パルス (Φ 1)
 - 8、8′ シフトレジスタ駆動パルス (Φ2)
 - 9、9′ 次チップスタート信号線
 - 9-1、9-1' 高解像モード時スタート信号線
 - 9-2、9-2′ 低解像モード時スタート信号線
 - 10、10′ スタート信号切り替え手段
- □ 11 シフトレジスタブロック(4ビット分)
 - 12-1~12-4' Φ1同期1ビットシフトレジス タ
 - 13-1~13-4' Φ2同期1ビットシフトレジス タ
 - 14 共通信号線
 - 14-1 光信号共通信号線
 - 14-2 ノイズ信号共通信号線 ---
 - 15 共通信号線リセットスイッチ
 - 15-1 光信号共通信号線リセットスイッチ
- 50 15-2 ノイズ信号共通信号線リセットスイッチ

(11)

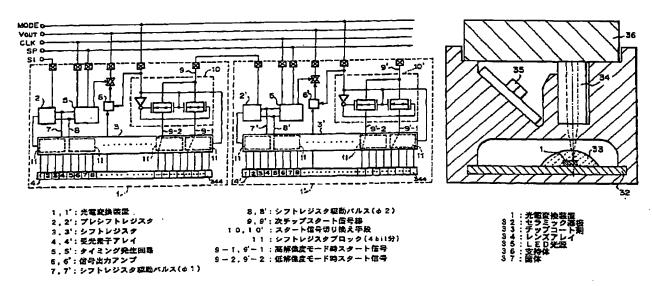
19203 2 セラミック基板a 1 ~ d 2 受光素子3 3 チップコート剤Φ a 1 ~ Φ d 2 a 1 ~ d 2 読み出しパルス

34 レンズアレイ Mla~Mld 読み出しスイッチ

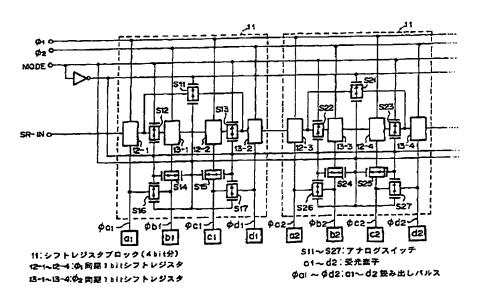
3.5 LED光源 M4a~M4d リセットスイッチ

3 6 支持体 PDa~PDd ホトダイオード 3 7 筐体

[図1]

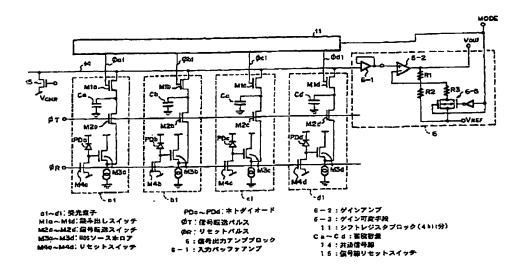


【図2】

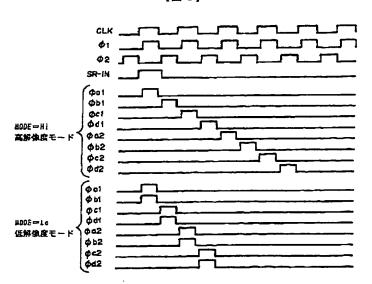


(12)

【図3】

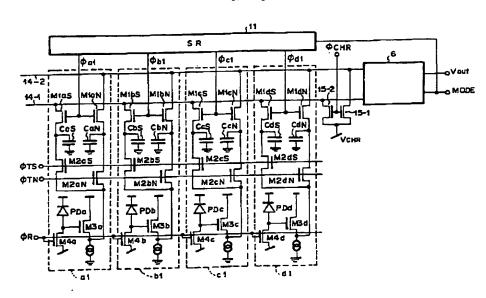


【図4】

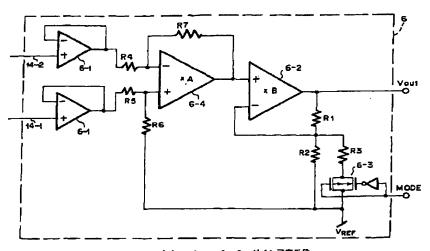


(13)

【図5】



【図6】

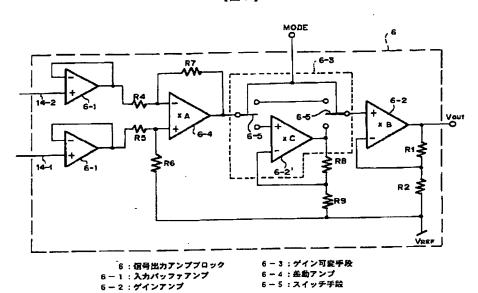


6 : 信号出力アンプブロック 6 — 1 : 入力パッファアンプ 6 — 2 : ゲインアンプ

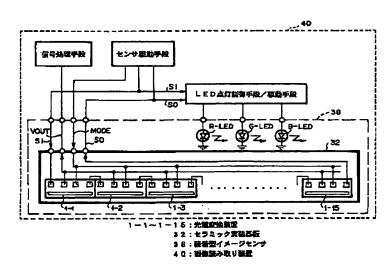
6 - 3:ゲイン可変手段 6 - 4: 差動アンプ

(14)

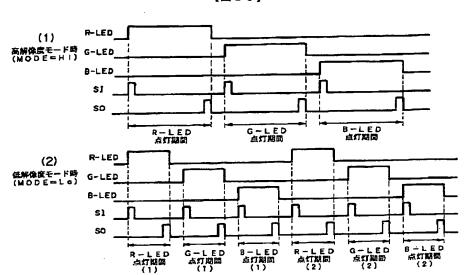
【図7】



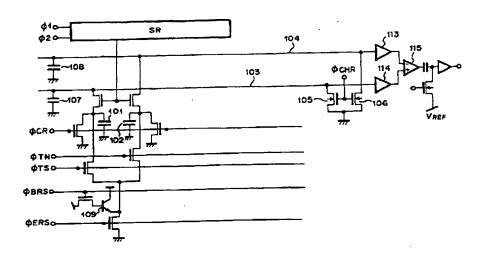
【図8】



【図10】

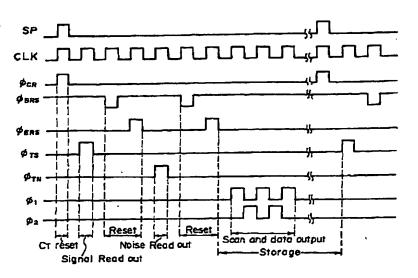


[図11]

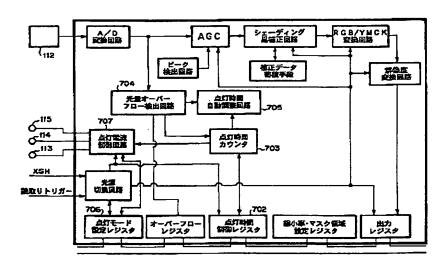


(16)

【図12】

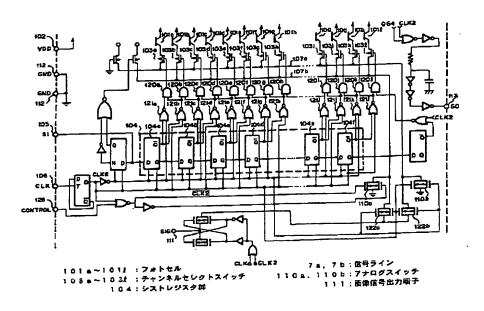


【図13】



(17)

【図14】



フロントページの続き

Fターム(参考) 5C051 AA01 BA03 DA03 DA06 DB09

DB22 DB29 DC03 DC04 DC05

DC07 DE02 DE03 DE07 DE09

DE12 DE13

5C072 AA01 BA11 CA05 CA09 CA12

DA03 EA05 FA07 FB15 FB17

MB01 MB04 TA05 XA01

5C077 LL02 LL17 LL18 MM05 NP07

PP11 PP20 PP47 PQ03 PQ08

PQ22 SS01 SS03